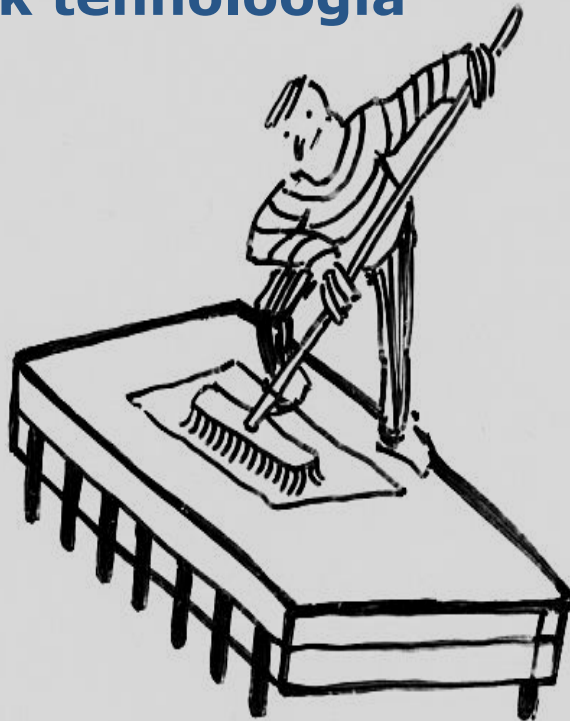




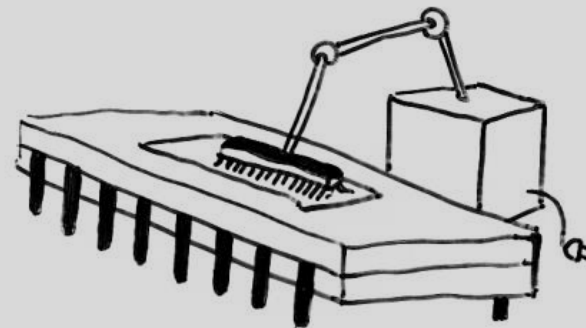
ehk tehnoloogia



valitsemisest ja

Inseneri ja tehnoloogia võidujooksust nanomeeterdistsantsil

Raimund Ubar



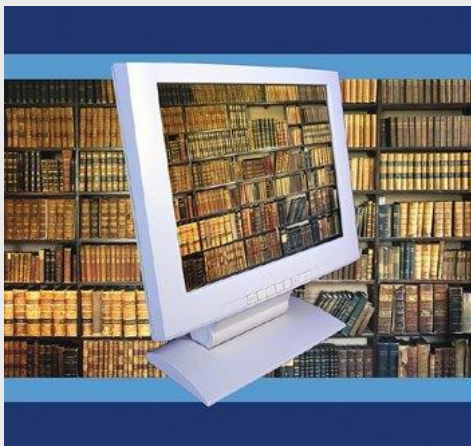
usaldamisest

Positsioonidest sellel võidujooksul?

- ✓ Kes järgneb kellele? Tehnoloogia vs. inimene?
 - **Tehisintelligents.** Kas me saavutame selle?
 - **Tehnoloogiline singulaarsus.** Kas inimene jääb tehnoloogiat valitsema?
 - Üks dzhinn on pudelist välja pääsenud – **Internet**
 - Kas see on hea dzhinn või halb dzhinn?
Seda ei tea me veel
 - Me ei tea veel, kuidas infoplahvatus mõjub inimese mälule, tähelepanule ja vaimsetele võimetele



Revolutsioonid ja kirjaoskus



✓ Kolm tehnoloogilist revolutsiooni

- Põllumajandusrevolutsioon
- Tööstusrevolutsioon
- **Digitaalne revolutsioon**

✓ Neli kirjaoskust

- Lugeda ja kirjutada lineaarset teksti
- Oskus arvutit kasutada
- Oskus leida andmetulvast infot
- **Oskus luua arvutitarkuse abil imesid ehk uut tarkust**



Quo Vadis, tehnoloogia?

- ✓ **Innovatsioon:** autotööstuse innovatsioonist on 90% seotud elektroonikaga
- ✓ **Tehisintelligents** ei teki inimese käe läbi mingi projektina
- ✓ **Tehismaailma evolutsioon**, kus masinprojekteerimine ja automaatne tööstus on haaratud positiivse tagasisidega, viib tehisintelligentsini
- ✓ Kõik, mida insenerid on teinud head on – **99%**
- ✓ Ülejäänud **1%** tähendab inseneride **süüd** ühiskonna ees, mis tuleb lunastada



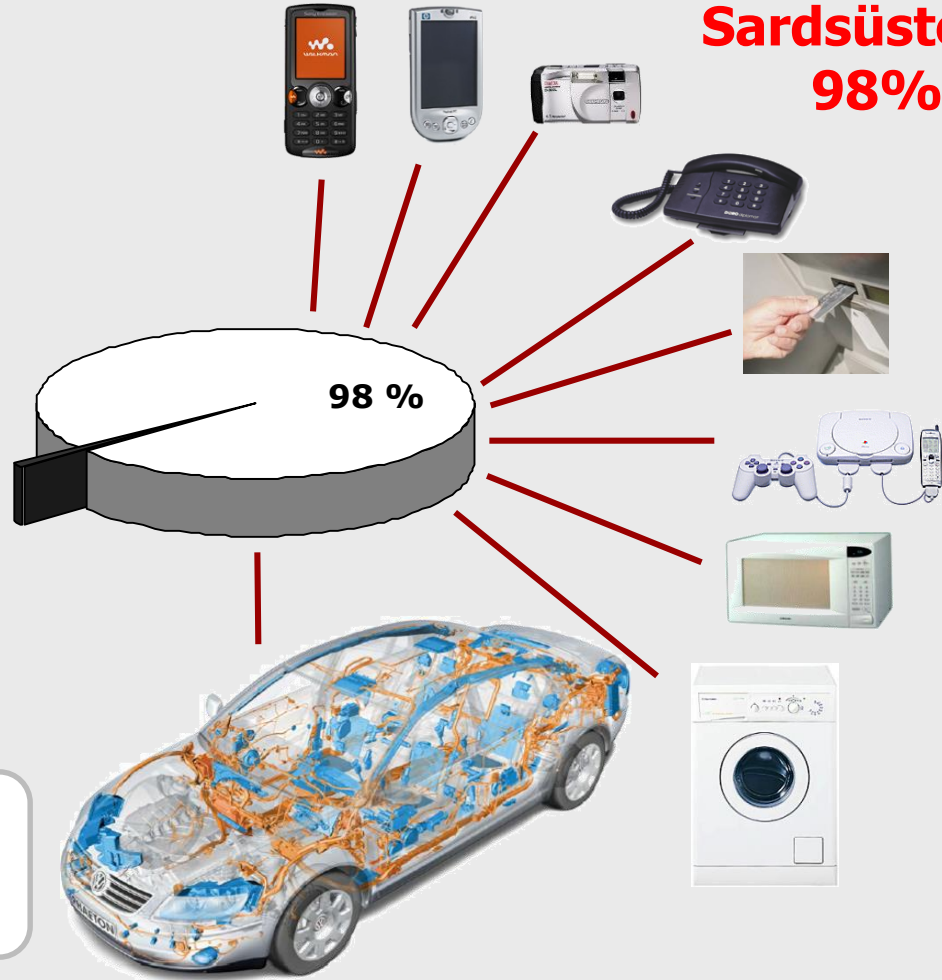
Domine, quo vadis ? Annibale Carracci (1602)

Arvutid ja sardsüsteemid

**Universaalarvutid
2%**



**Sardsüsteemid
98%**



**Oleme arvutisõitlased,
kuid märkame seda sõltuvust
alles siis, kui tehnika tõrgub**

Millest edasi juttu tuleb?



- ✓ **Elektroonikast**
- ✓ **Tehnoloogia trendidest**
- ✓ **Süsteemidest**
- ✓ **Usaldusest**
- ✓ **Testimisest**
- ✓ **Graafidest**
- ✓ **ATIst**
- ✓ **CEBEst**

Sardsüsteemid

- ✓ **Sardsüsteem** (*embedded system*) – arvuti tehissüsteemi lahutamatu funktsionaalse osana
- ✓ Teisi nimesid: rakendusarvutid, kinnissüsteemid, rakissüsteemid, reaktiivsüsteemid...
- ✓ Põhikriteeriumid: reaalaeg, madal energiatarve, **töökindlus, usaldatavus**

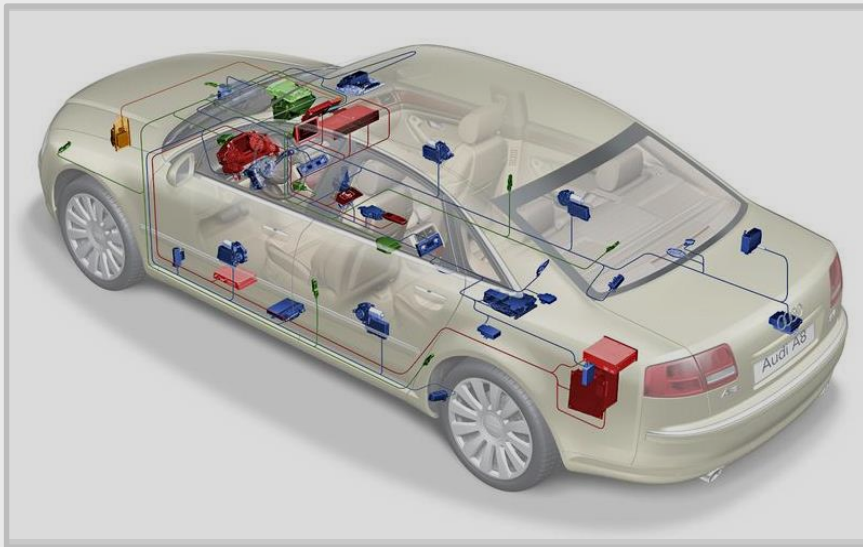


- ✓ **Missioonikriitilisus** – vs. “best effort systems engineering” ehk “nii-head-kui-võimalik” süsteemid
- ✓ **Innovatsiooni süda ja hing**, mida publik ei näe otseselt – “ubiquitous computing” ehk ubikviidne või “kõikjal olev”

Sardsüsteemide levik

✓ Mobiiltelefonid

- **Mobiiltelefonide arv aastal 2009 oli 4,6 miljardit**
- 5 aastat tagasi ennustati nende arvuks 4 miljardit aastal 2011
- 20 aastaga on nende arv suurenenud 370 korda



✓ Autod

- **Uusimate autode mudelites on enam 100 sardsüsteemi**
- Kokku annab autonduse turg 7% Euroopa GNP-st

✓ Meditsiin

✓ Tööstusautomaatika

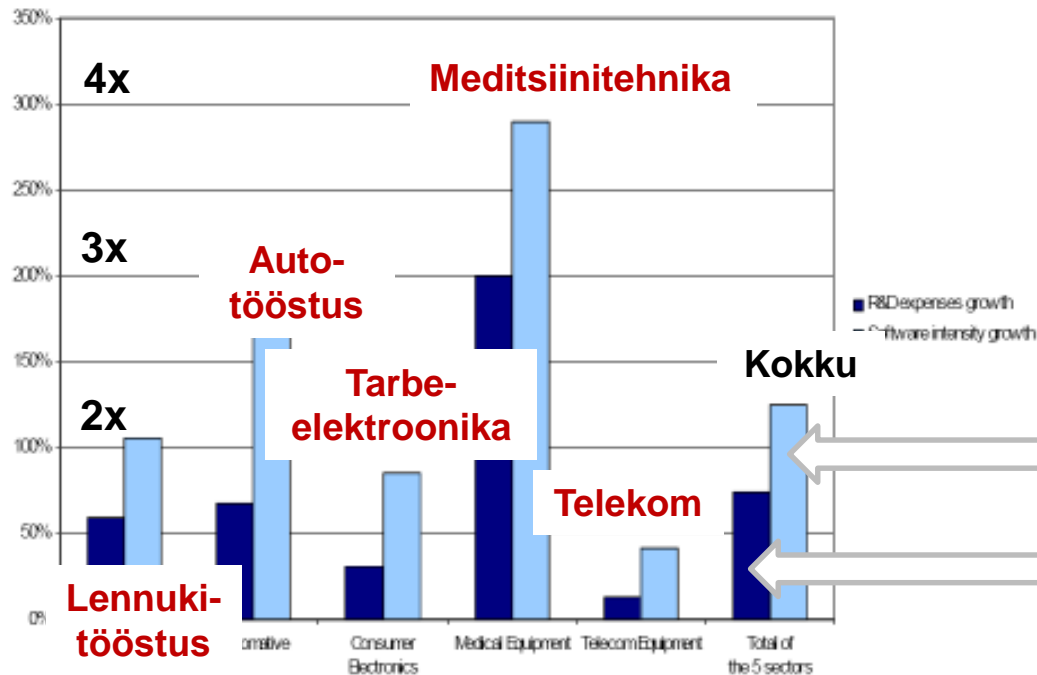
✓ Robotika

✓ Targad hooned

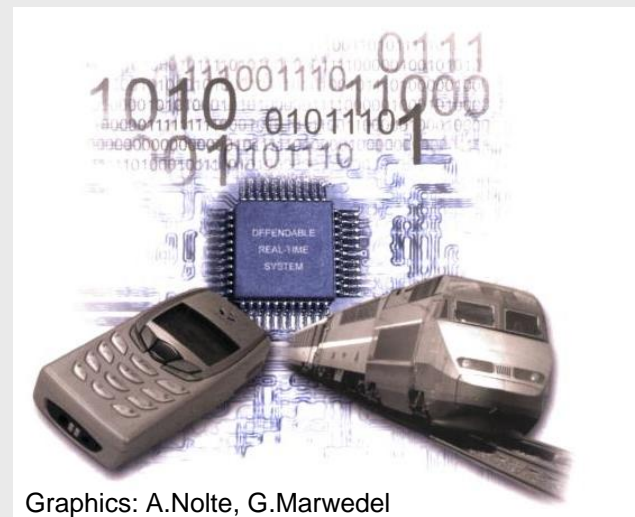
Tarkvaratööstuse kasv (2002-2015)

Ca 50% süsteemide arendustöö kuludest langevad tarkvarale

R&D expenses and software intensity over the period 2002-2015 in the 5 main sectors



Source : IDATE



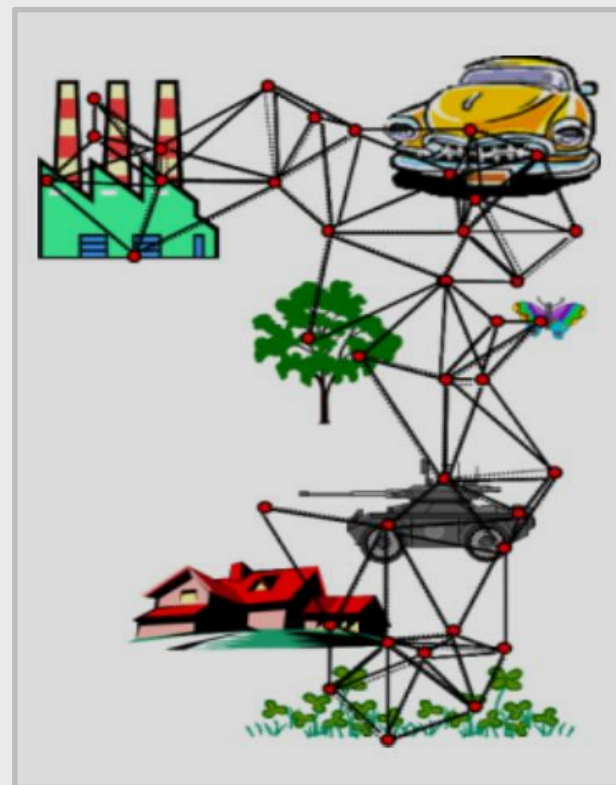
Graphics: A.Nolte, G.Marwedel

Tarkvara kulutused

Teadus-arendustöö kulutused

Eurodest ja dollaritest

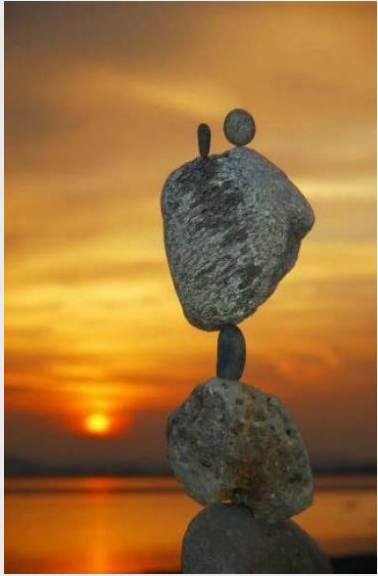
- ✓ Planeedil hinnatakse olevat praegu 16 miljardit sardsüsteemi
- ✓ Tarkvara väljatöötamiskulud Euroopas ühe aasta vältel on 1600 miljardit eurot
- ✓ Elektroonikatööstuse maht
 - ✓ Terves maailmas - 1378 miljardit dollarit
 - ✓ Saksamaal 160 miljardit eurot
- ✓ **Tarkvara** projekteerimise kuludest läheb kuni **50%** vigade otsimisele ja kõrvaldamisele
- ✓ **Riistvara** projekteerimise ja valmistamise kuludest läheb kuni **70%** testimisele ja diagnostikale



Kategooriline imperatiiv

- ✓ Süsteemide **kvaliteet** – inseneri kategooriline imperatiiv
- ✓ Kvaliteedi (**usaldatavuse**) tagamine läheb üha raskemaks tehnoloogia keerukamaks muutumisel ja süsteemidele üha vastutusrikkamate ülesannete andmisel
- ✓ *Design for dependability* – **usalduse projekteerimine**
- ✓ Vajame uut tüüpi inseneriharidust, “usaldusinseneri”, teadusuuringuid selles vallas
- ✓ Objekt “jookseb kiiremini eest ära” kui talle järele jõuame. Uued tehnoloogiad nõuavad uusi paradigmasid, uusi teooriaid
- ✓ Üheks meetodiks on – **kiiruse piirangud**
 - maanteeliikluses – oleme sellega harjunud
 - aga kiipides – **paradoks**

Veakindlus



- ✓ Nanotehnoloogia ajastu algab 100 nm transistori mõõtmest, täna on see 30 nm
- ✓ **Vigastest elementidest on vaja teha töötavaid süsteeme**

- ✓ **Immuunsüsteem:** ei saa garanteerida rünnete ja rikete puudumist
- ✓ Aga võime näha ette vahendeid immuunsuse (robustsuse) loomiseks

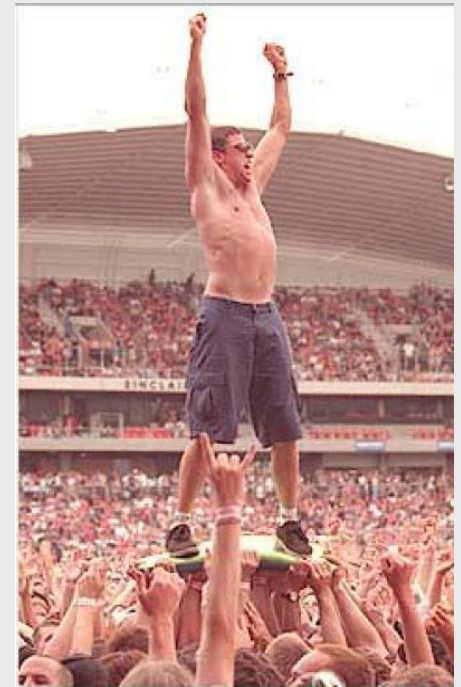


Photo # NU 06566 KN First Computer "Bug", 1945

Koiliblikas

0800 Antenn started
 1000 stopped - antenn ✓
 1300 (033) HP-AC 1.2700 9.037 847 025
 033 PRO 2 2.13047 045 9.037 846 095 correct
 correct 2.13067 045 4.615925059(-2)
 Relays 6-2 in 033 failed special speed test
 in relay 1.000 test.
 Relays changed
 Started Cosine Tape (Si. check)
 Started Multi-Adder test.
 1545 Relay #70 Panel F
 (moth) in relay.
 First actual case of bug being found
 Antenn started.
 1700 closed down.

Legend:
 Nii sündiski termin
Debuging

Rikked arvutites

- ✓ **1945.** Esimene arvutiviga maailmas:
 - Koi sattub Harwardis arvuti Mark II kahe rele vahele
 - Logiraamatusse kirjutati: ***"Hey, we actually found a bug that was a real bug!"***

✓ **1991.** Lahesõda

- Iraagi rakettab USA raketibaasi barakke ja tapab 28 sõjaväelast
- ***Põhjus:*** ümardamisviga Patrioti radarisüsteemis (0,35 s, rakettab läbis 0,5 km); raketi trajektor arvutatakse valesti, arvuti ei oska jagada 10-ga (registris oli vaid 24 bitti)

✓ **1995.** Intel Pentiumi protsessor jääb vahele jagamisega

- Jagamise algoritm kasutas tabelit, milles oli 1066 arvu. Tabeli laadimisprogrammis oli tsükli viga, mille tõttu kirjutati tabelisse 5 arvu vähem

Viie aastaga on kasvanud USA-s kahjum arvutivigadest **5 korda**, ulatudes praegu **60 miljardi dollarini** aastas

**Eksimine on inimlik, aga et
tõeliselt kõike ära rikkuda,
on vaja arvutit**

**Arvutirikete mõju ulatub
arvutist palju kaugemale**



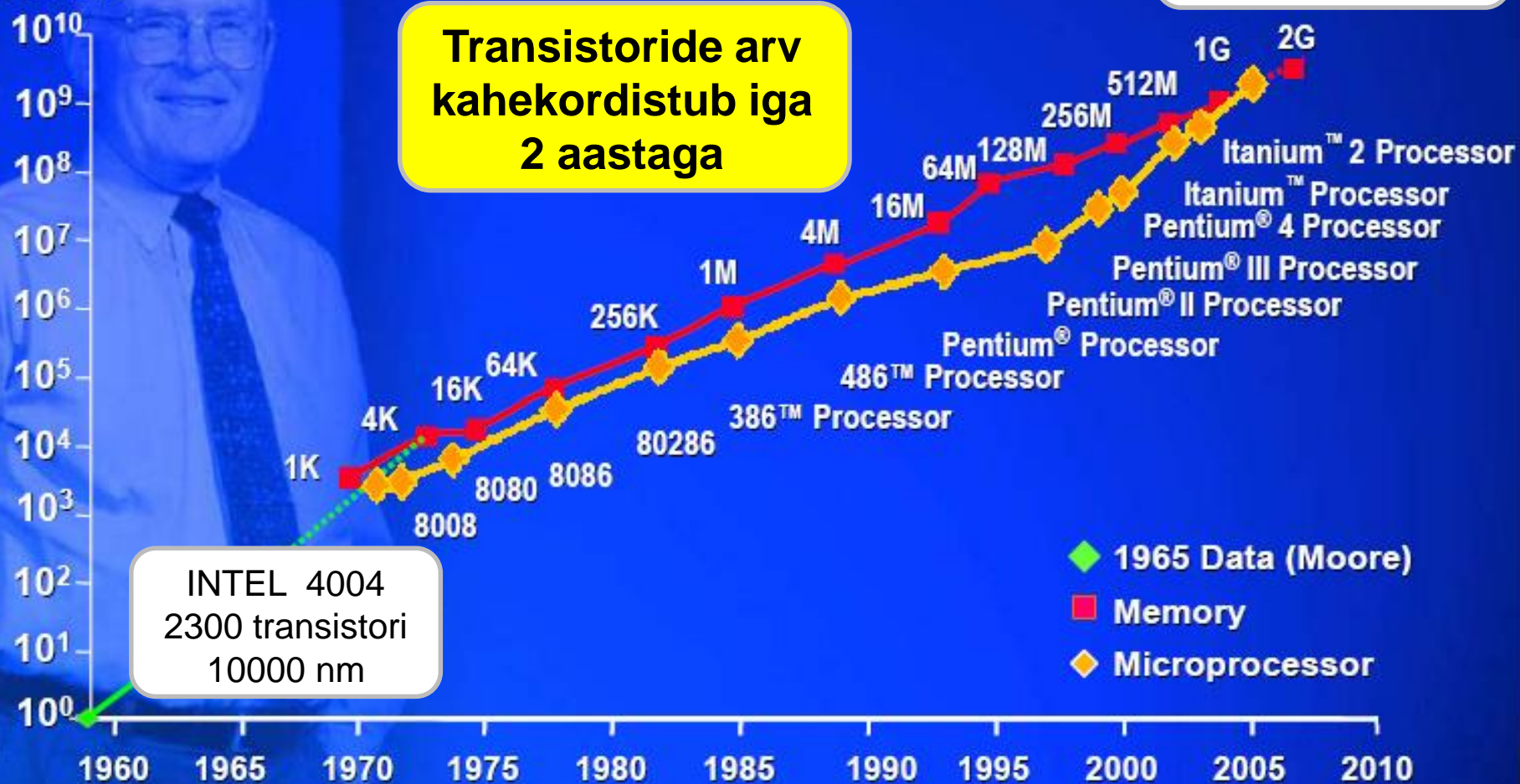
Zebo Peng, U Linköping

Rikked arvutites

- ✓ Pidurisüsteemi rike Toyota autodes
 - Hetkeline süsteemi tundetus hüdraulika ja elektroonika ümberlülitamisel
 - 4,5 miljonit autot tagasi ostetud
 - Majanduslik kahjum 2 miljardit dollarit
 - Firma aktsiad kukkusid ühe päevaga 22%
- ✓ Kosmiliste kiirte mõju?
 - ✓ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) uuringud seoses Toyota probleemiga

Moore's Law - 2005

Transistors
Per Die

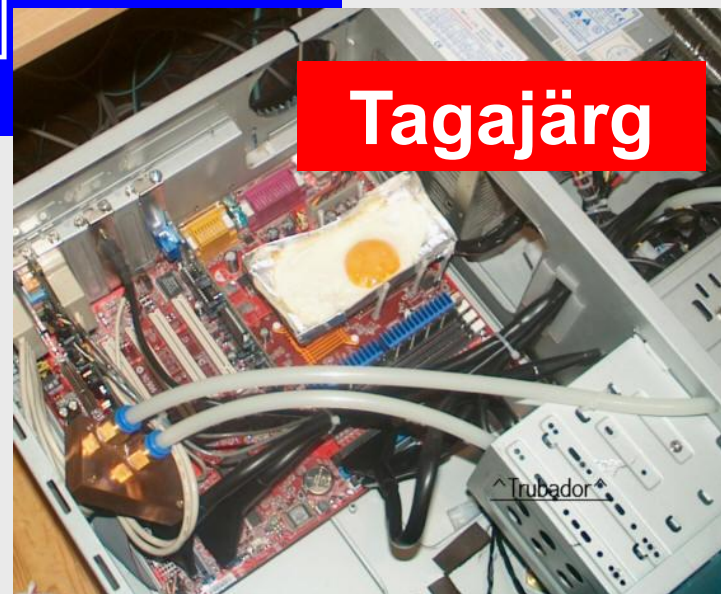
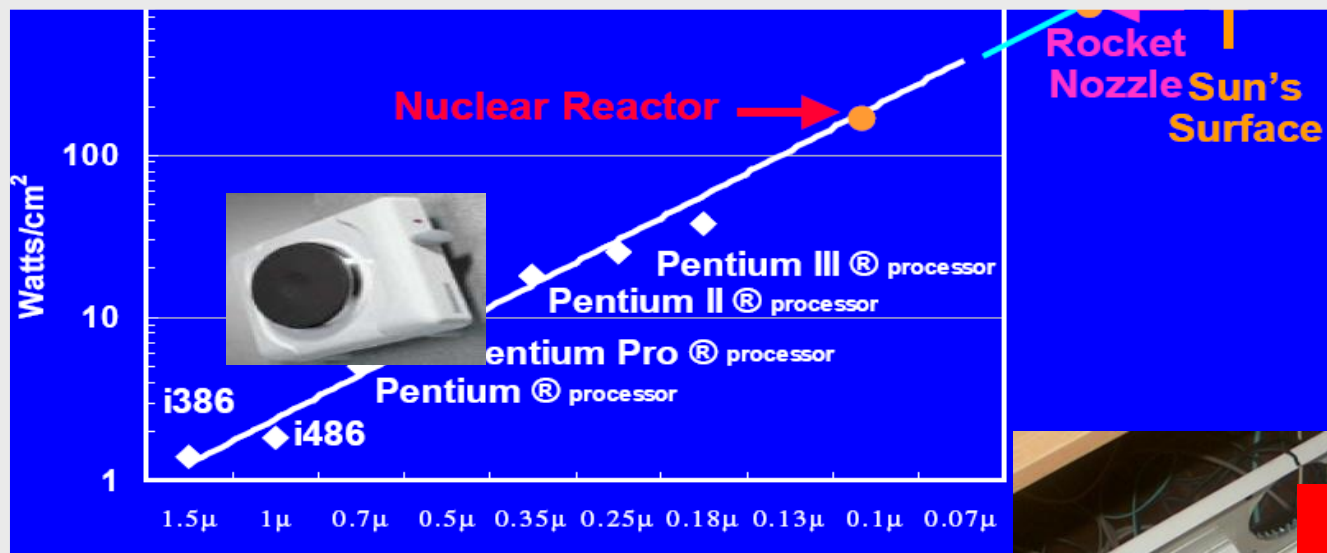


INTEL 4004
2300 transistori
10000 nm

INTEL 8-core Xeon
2,3 miljardit transistori
45 nm

- ◆ 1965 Data (Moore)
- Memory
- ◇ Microprocessor

Energiatihedus



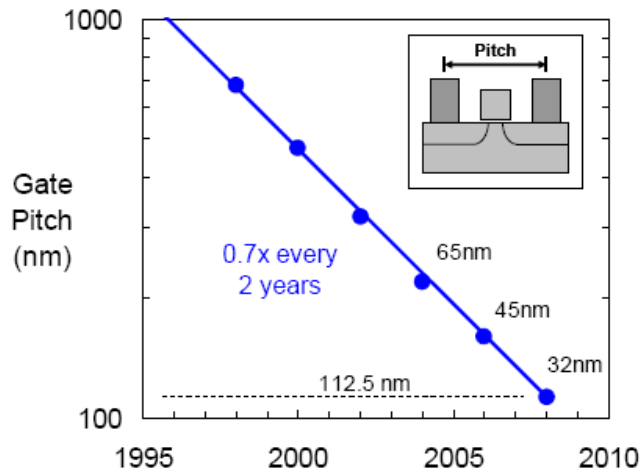
Source: Fred Pollack (Intel Corp.), Micro 32

Töökiiruse ja energiatiheduse kasv viib temperatuuri kasvule kiipides

Moore² seadus

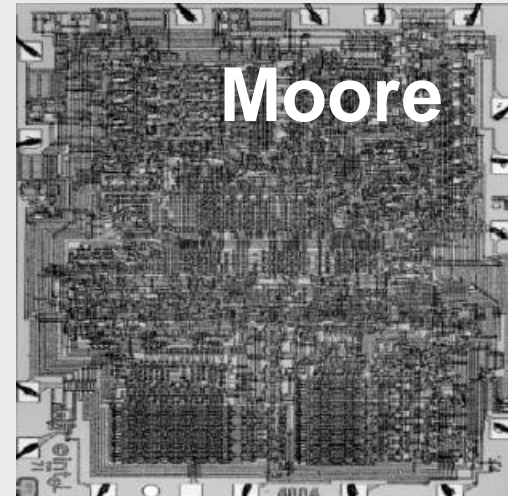
Intel 32 nm transistori suurus – 112 nm

Transistor Density



Intel 32 nm transistors provide the tightest gate pitch of any reported 32 nm or 28 nm technology

IDF2009
INTEL DEVELOPER FORUM



Moore² :
tuumade arv
kordistub
2 aastaga

16-Core Tile Architecture

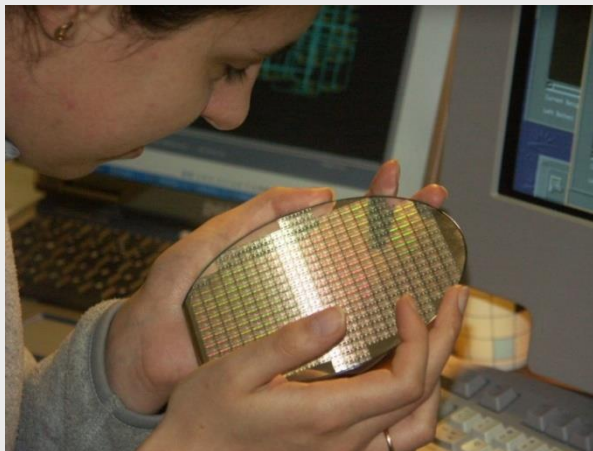
Kui kaua kehtib veel Moore'i seadus?

- ✓ Eksponentsiaalne innovatsiooni kasv on toimunud eeskätt tänu Moore'i seadusele
- ✓ Kui seadus lakkab toimimast, lakkab ka **innovatsiooni** senine kasv
- ✓ Kiipide töösagedus ei ole enam näitaja
- ✓ Tähtsam on jõudlus, mis sõltub **paralleelsuse** paradigmast
- ✓ Hiina uue superarvuti töökiirus on **2,5 petaflopsi** (14 tuh. Intel Xeon, 7 tuh. Nvidia Tesla GPU)

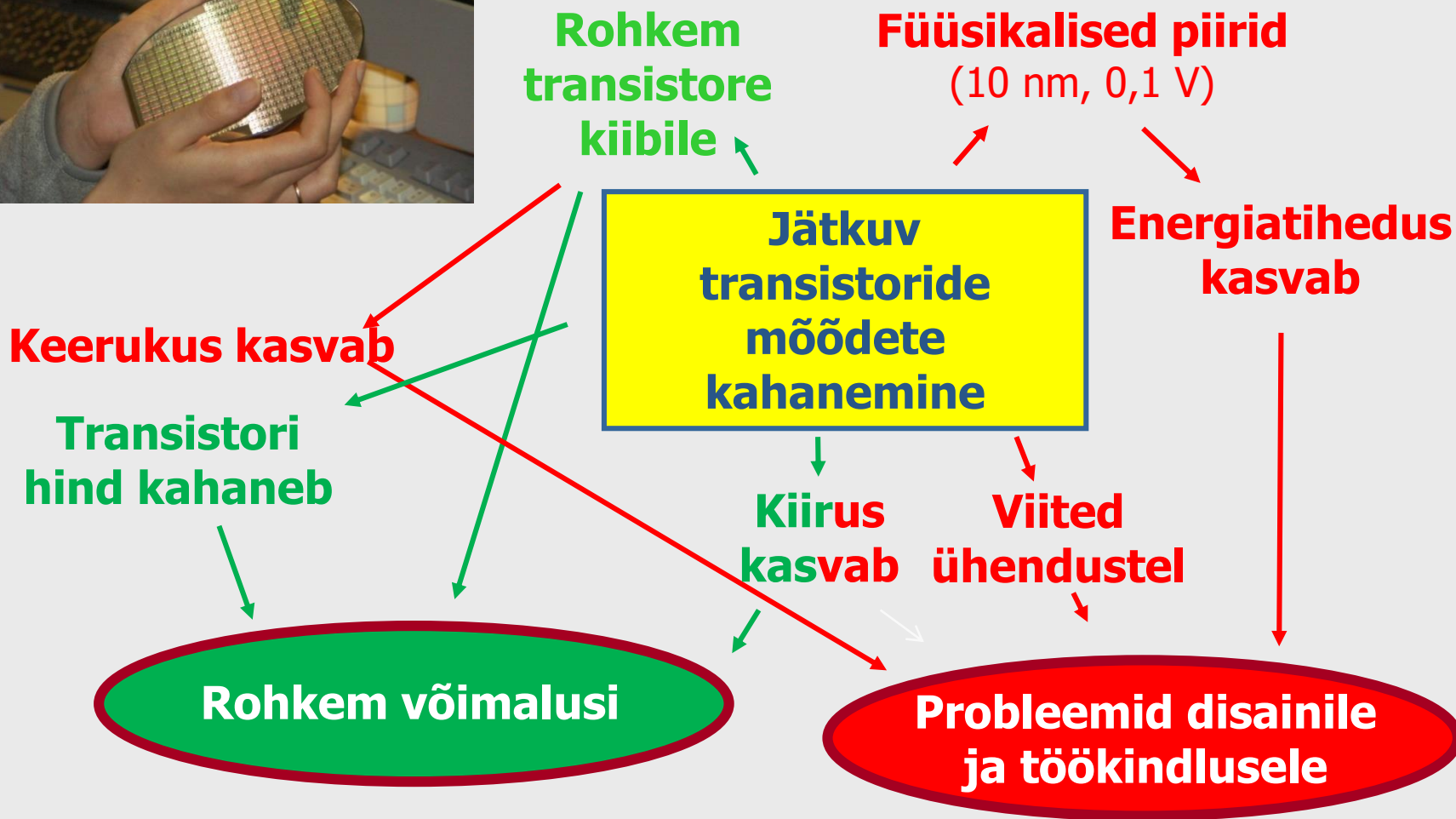


Protsessorite näitajaid - 2010

Tüüp	Sagedus	Trans. arv	Jõudlus
Tianhe 1A superarvuti			2,5 PetaFlops
AMD GPU			2,7 TeraFlops
IBM Power7 CPU			260 GigaFlops
Intel CPU	4,8 GHz		100 GigaFlops
NVIDIA GPU		3,0 · 10⁹	
ALTERA FPGA		2,5 · 10 ⁹	
Intel 8 Core XEON		2,3 · 10 ⁹	



Trendid ja mõjud



Tehnoloogia on kaugel ees



Produktiivsuse kriis

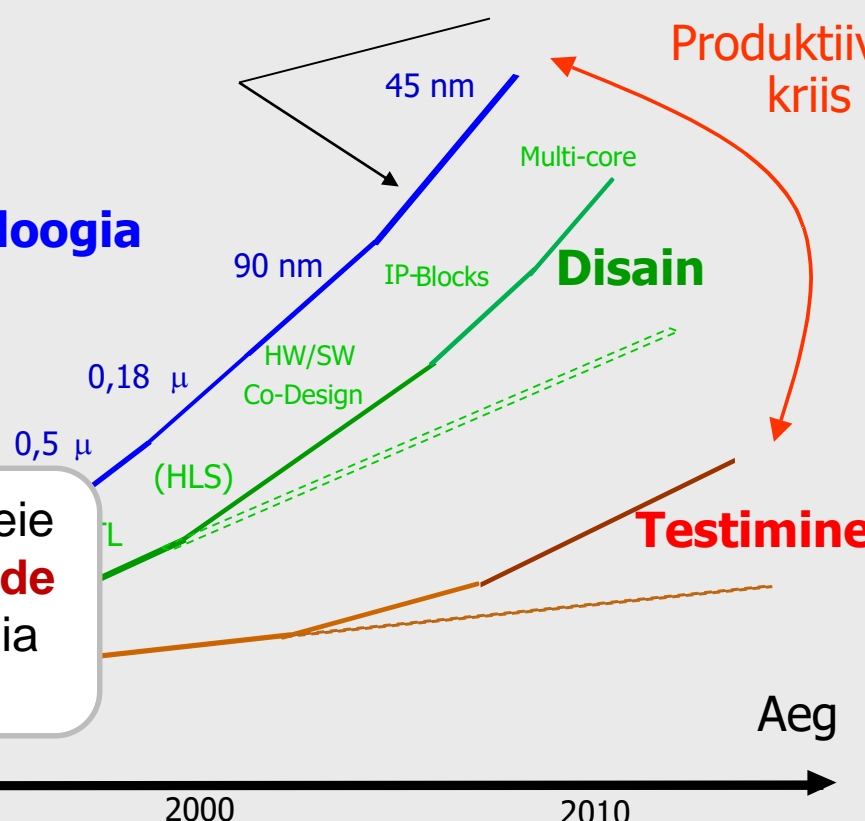
50% - Keerukuse kasv / aastas



Tehnoloogia

Moore'i seadus

Produktiivsuse kriis

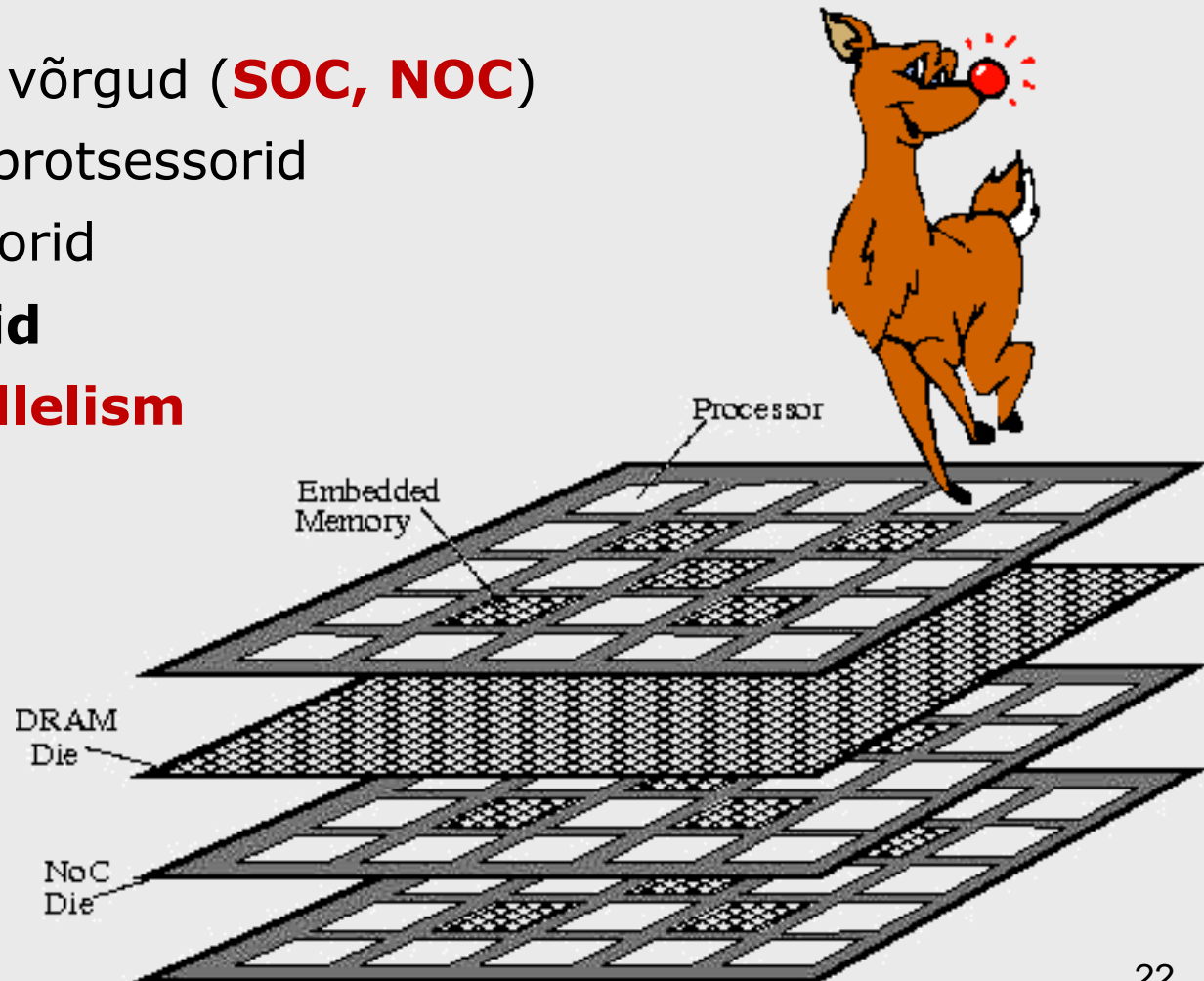


Tehnoloogia areneb kiiremini kui meie kultuur vastu võtta suudab. **Inseneride võimed** ei ole vastavuses tehnoloogia võimalustega

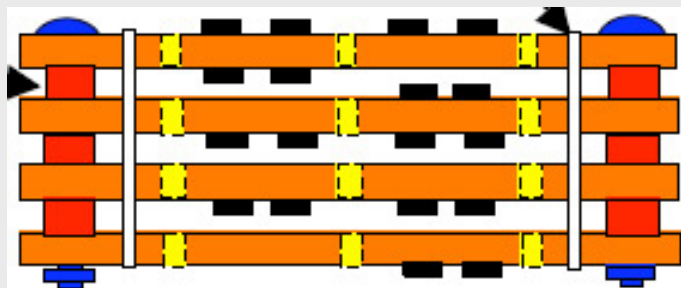
1990 2000 2010 Aeg

Uued paradigmad

- Kiipsüsteemid ja võrgud (**SOC, NOC**)
- Multituumalised protsessorid
- Graafikaprotsessorid
- **3D arhitektuurid**
- **Massiivne parallelism**



3-D kihilised arhitektuurid



Võib taotleda ka heterogeensust



Krish Chakrabarty, Duke U, USA

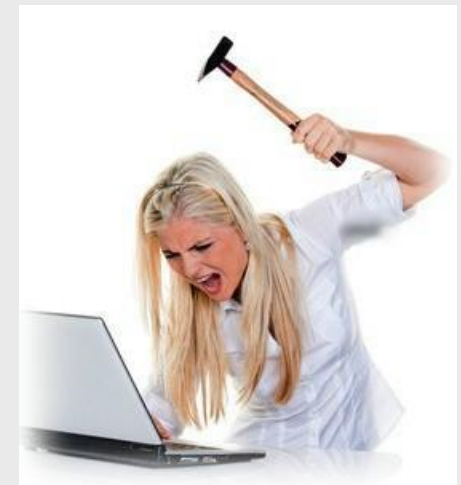
**Vertikaalne integratsioon
ei ole uus idee**

**Kui Maa peal ei ole enam ruumi,
siis tulebki suunduda üles**

Automatiseeritud design



- Protsessorid ja tarkvara tagavad põhifunktsionaalsuse
CAD: Synopsys, Mentor Graphic, Cadence
- **ASIC:** kallid eriotstarbelised kiibid leiavad edaspidi rakendust vaid ülikiiretes seadmetes ja masstootmises
- **FPGA:** programmeeritavad kiibid leiavad üha universaalsema rakenduse
- Projekteerimisvahendid standardiseeruvad üha rohkem: MatLab – **SystemC - VHDL**
- Kõik oleks tõesti tore, kui puuduks tülikas probleem nagu **defektid** aparatuuris, **vead** tarkvaras, **tõrked** ja **häired** väliskeskonna mõjudest ning **viirused** ja **troojad**

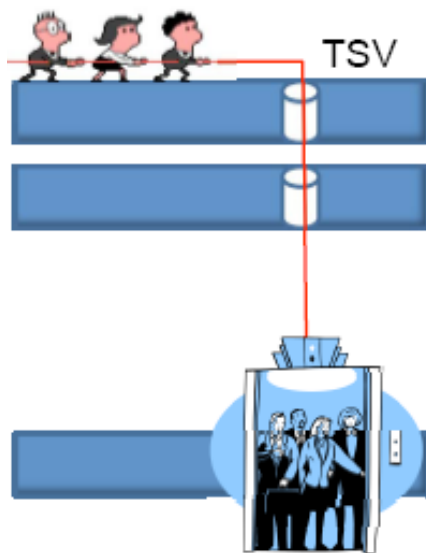
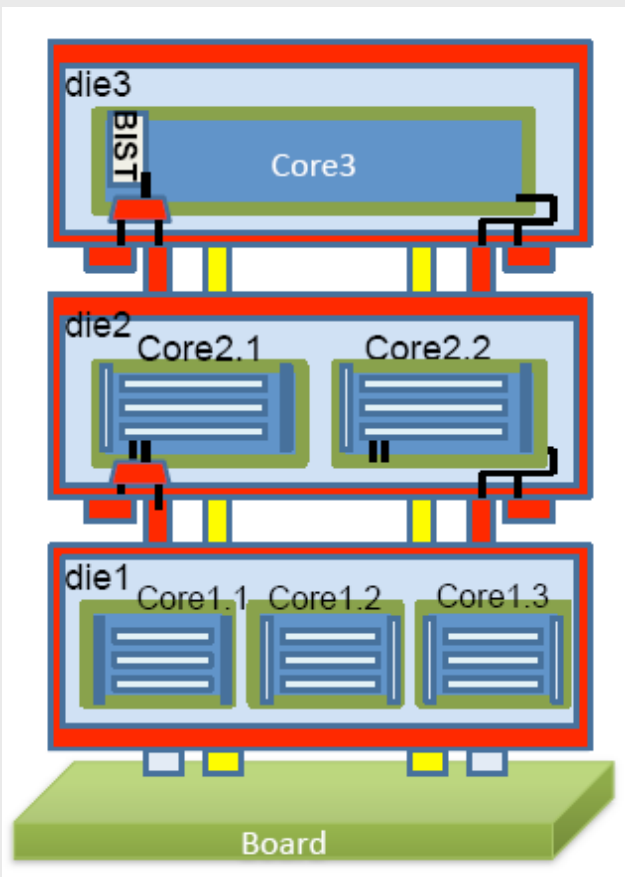


theisleofwightcomputergeek.co.uk

3-D multi-tuum arhitektuurid

Testprogrammide pikkust oleks vaja vähendada

Riketele on raske ligi pääseda – koridorid on pikad, ukseid käivad raskelt, liftid on ülekoormatud



Krish Chakrabarty, Duke U, USA

Animation: Yasuo Sato, KIT, Japan



jetpilot.dk

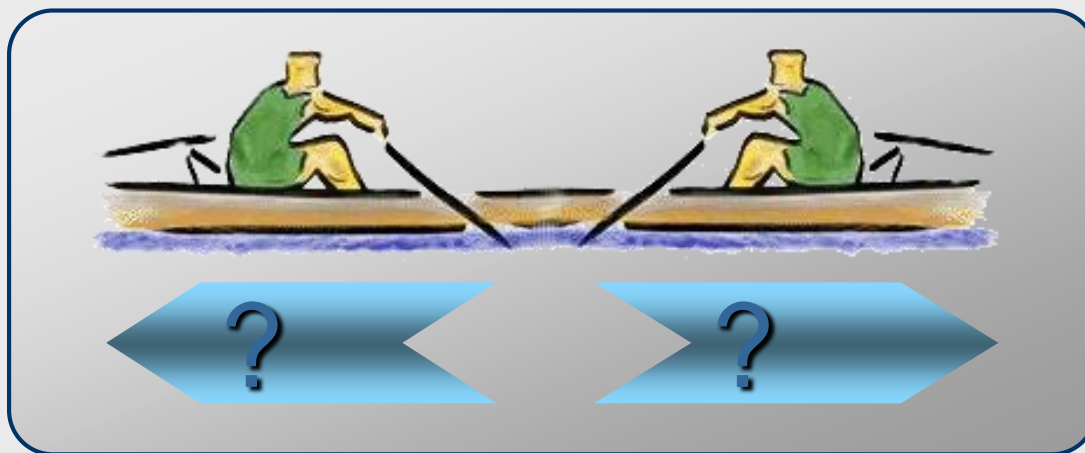
Disaineri ja testija koostööst

Disainer testijale:

- ✓ Kontrolli, kas kõik mu projekteeritud funktsioonid töötavad

Testija vastus:

- ✓ Projekteeri disain ümber selliselt, et testimine oleks üldse võimalik

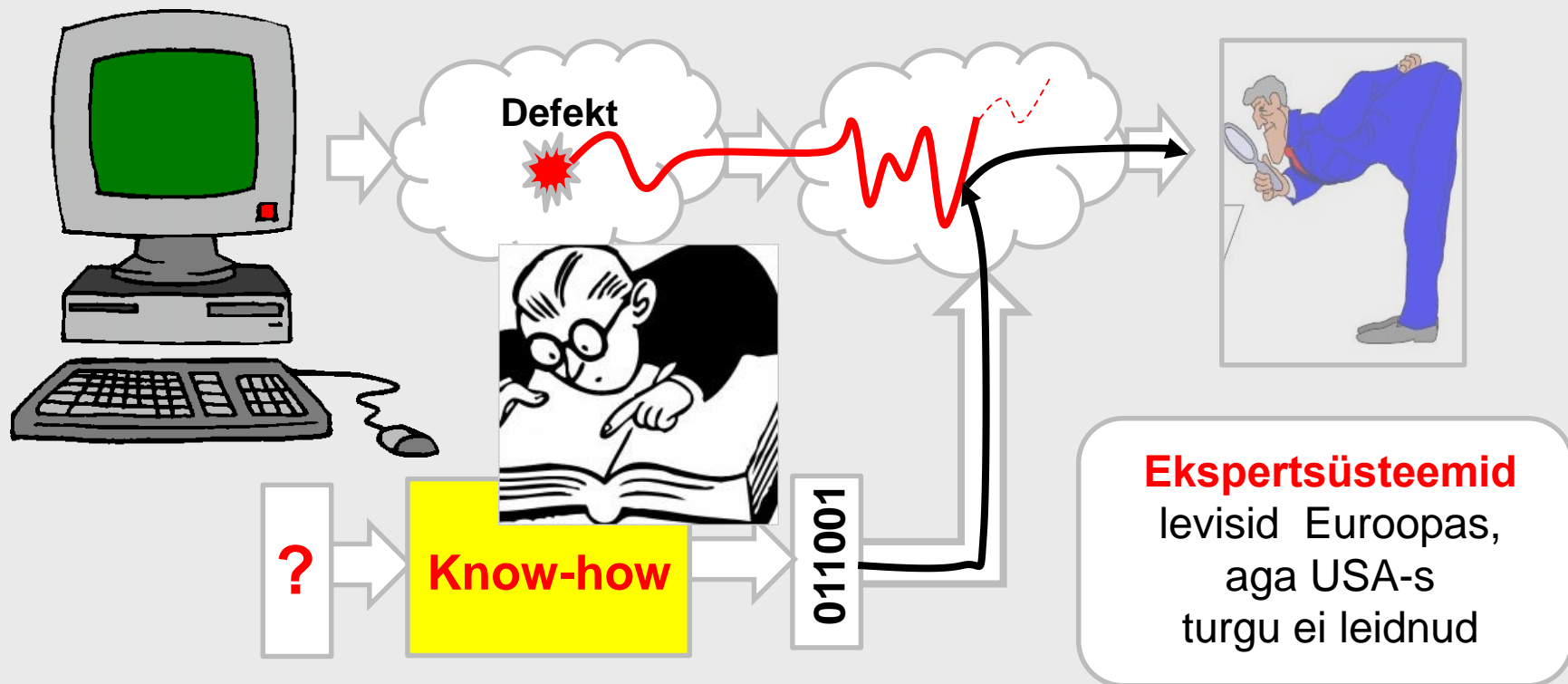


H.-J. Wunderlich, U Stuttgart

Paradigma muutus: ***Design for testability***

Omaette jäetud testija

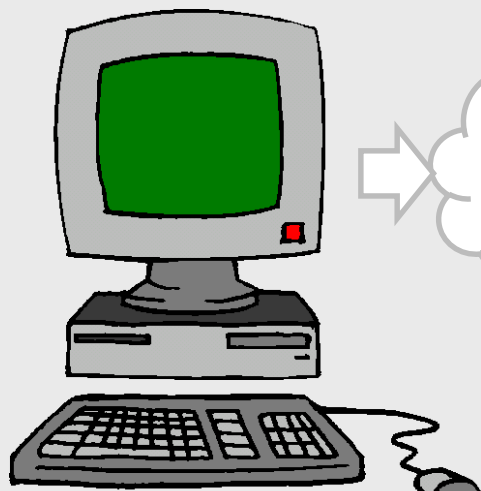
Testi süntees rikke avastamiseks



Ekspertsüsteemi appivõtmine

Disaineri ja testija koostööst

Testi süntees rikke avastamiseks



**Tülikas
skeemi osa**

011001

**Uus paradigma
ScanPath Design**

011001



Gordioni
sõlm

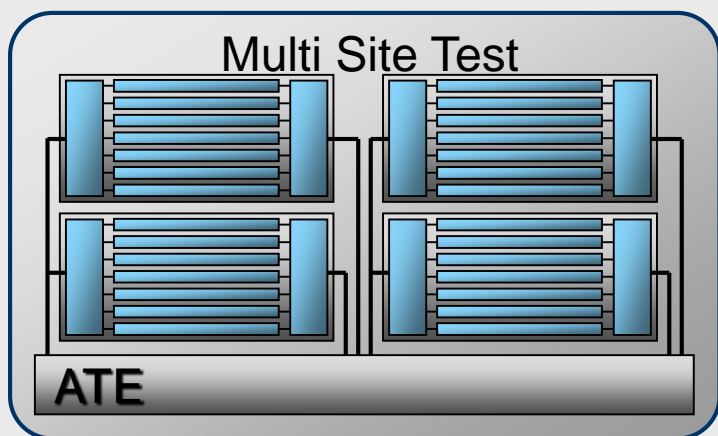
Alexander cuts the Gordian Knot



Jean-Simon Berthélemy (1743–1811)

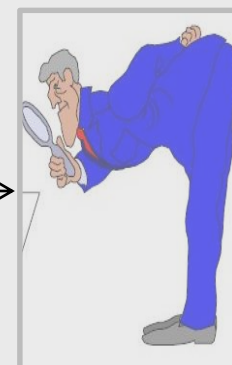
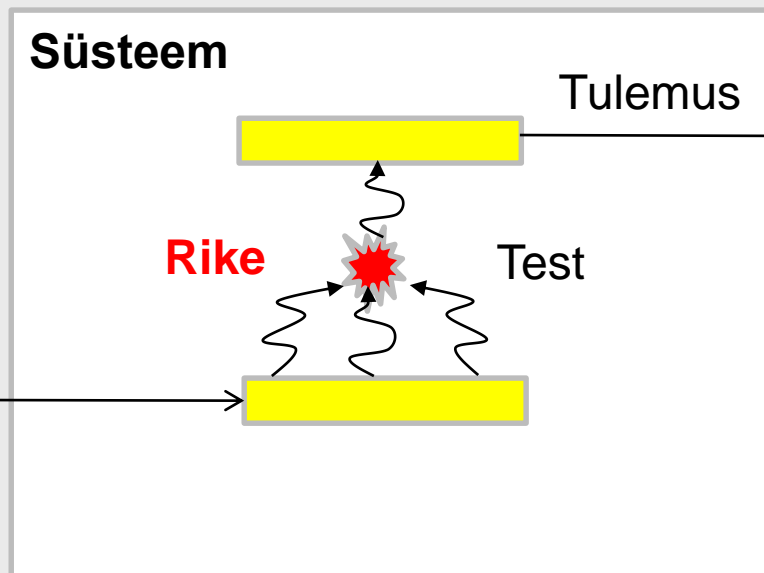
Disaineri ja testija koostööst

Kuidas testida koostöös sadat miljonit transistori

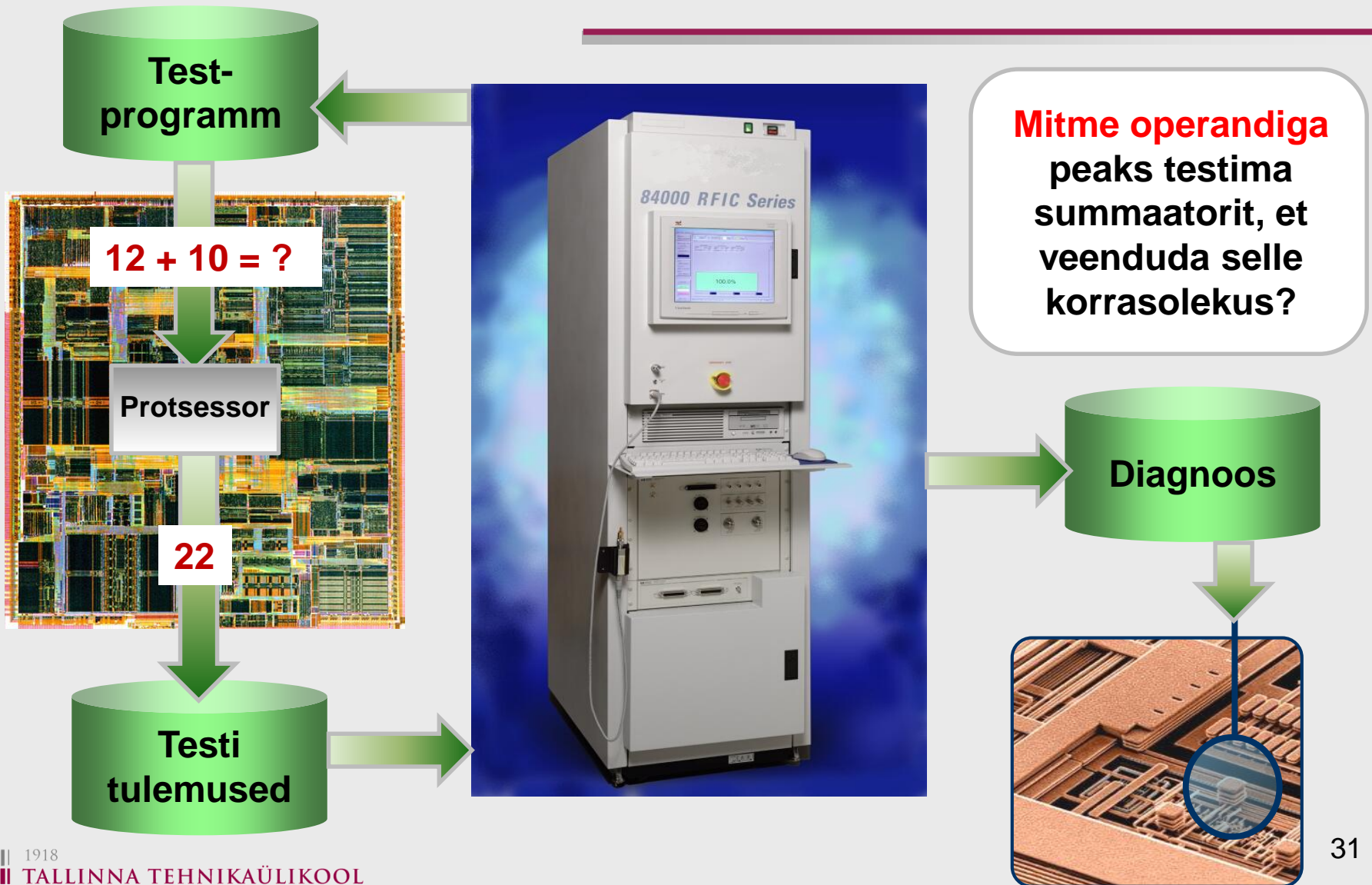


H.-J.Wunderlich, U Stuttgart

Kõik **mäluelemendid** (trigerid) tehakse testimise eesmärgil **“transparentseks”** nihkeregistrite abil



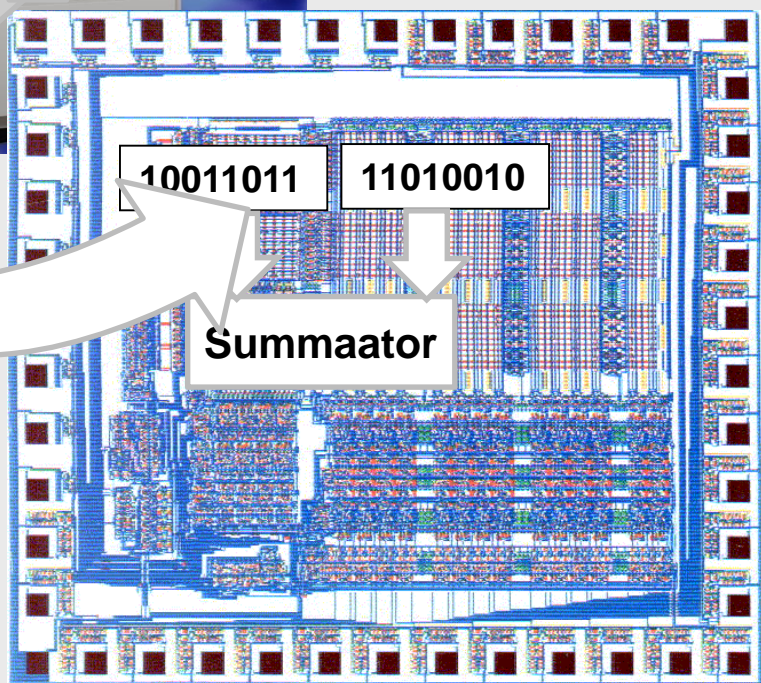
Mis asi on test?



Summaatori testimine?



32 bitisel summaatoril on 64 sisendit
Kõigi võimalike ombinatsioonide arv on
 $2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616 \approx 10^{19}$



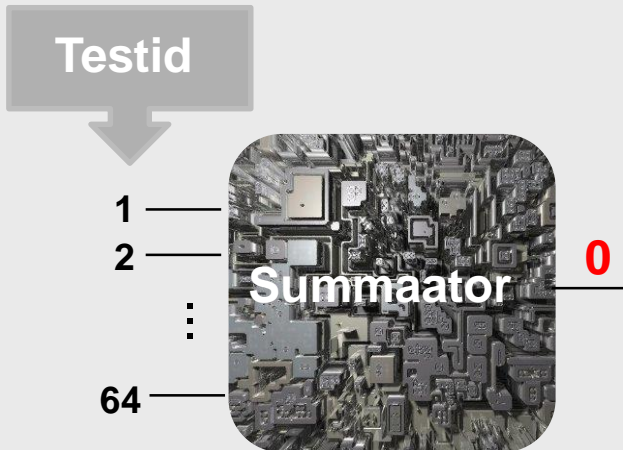
1 GHz protsessoriga kuluks
 $2^{64} = 18\,446\,700\,000 \approx 10^{10}$ sek
ehk **584** aastat



Mikroprotsessori
testimiseks tehase
konveieril aga antakse
aega vaid **10** sek

**Kuidas jääb siis lugu
testimise kvaliteediga?**

Achilles, kilpkonn ja digitaalsüsteemi test



Summaatori tõeväärtustabel:

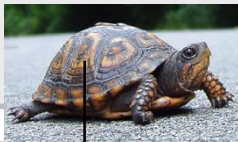
Testid	Funktsioonid
00...000	01 0 1 0 1...101
00...001	00 1 1 1 0...011
00...010	00 1 0 0 1...101
⋮	⋮
11...111	00 0 0 0 0...111

2⁶⁴

50% testitud

Esimene test

Õige tulemus



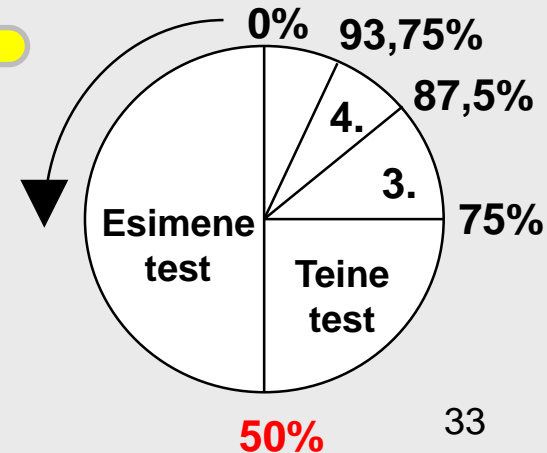
Start

Poollel teel



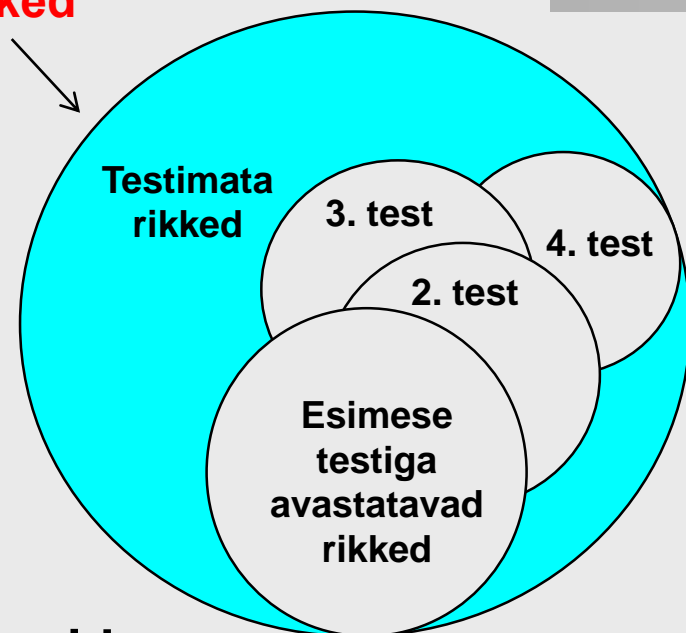
Testimise kvaliteet: 100%

Kilpkonn ja 100%-line test on kättesaadavad mõlemad



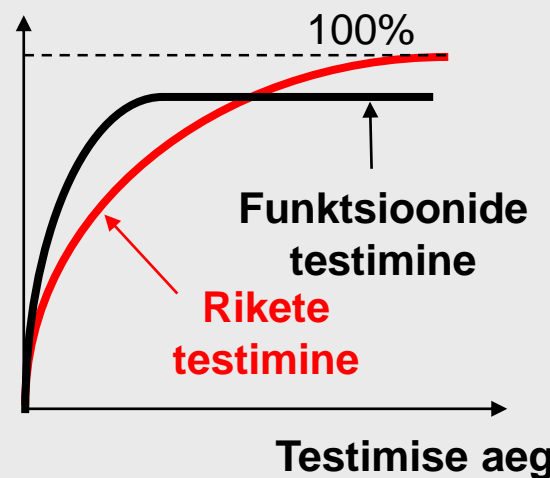
Struktuurne rikete-põhine testimine

Kõik rikked



100%-line testimise kvaliteet saavutatakse, kui **kõik rikked** antud nimistust on kaetud

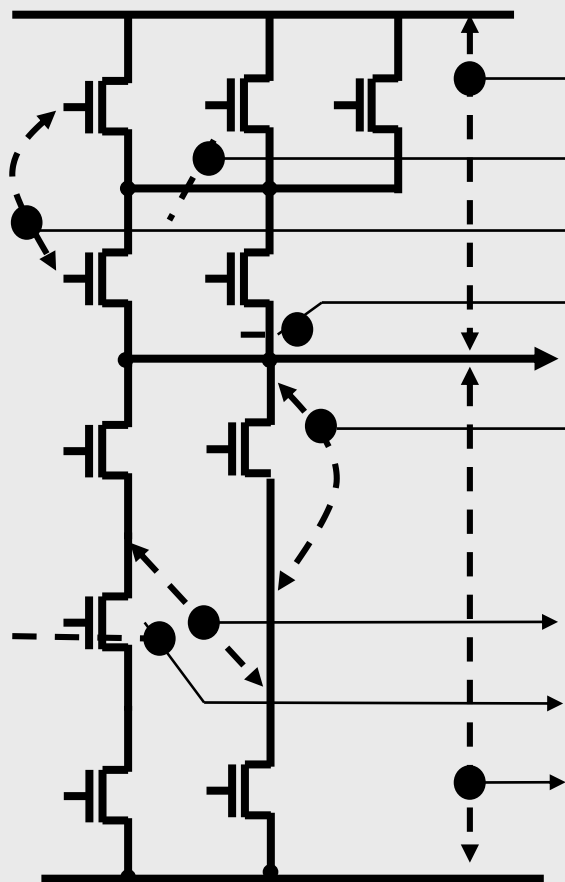
Testimise kvaliteet



Probleemid:

- Rikete loetelu on raske koostada, eri rikkemudelite hulk on väga suur
- Rikete mudeli tööstuslik standart on **konstantrike**, kuid see on puudulik
- Kordsed rikked võivad maskeerida üksteist
- Lahendamata probleem on: **riistvara Troojad**

Kuidas koostada rikete hulka?



Konstant-1

Juhe on katki

Lühis juhtmete vahel

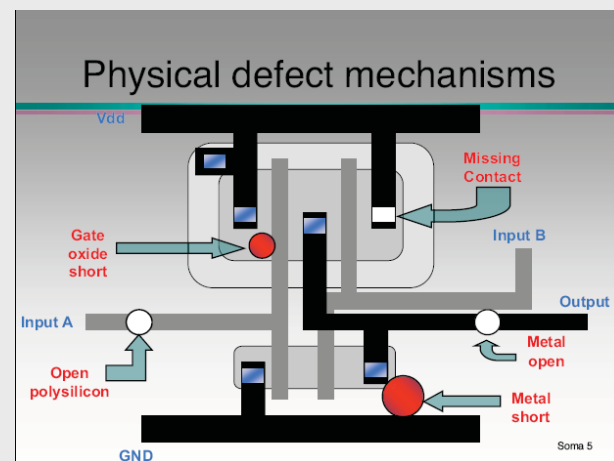
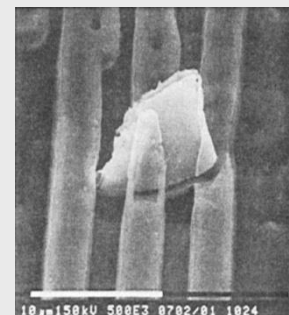
Juhe "ripub õhus"

Transistori lühis

Lühis transistoride vahel

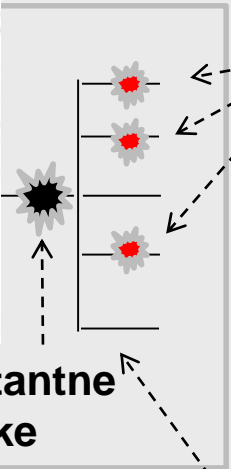
Transistor on katki

Konstant-0



© Mani Soma

Keerulisemad rikke mudeli üldistused



Kordne kombinatoorne rike

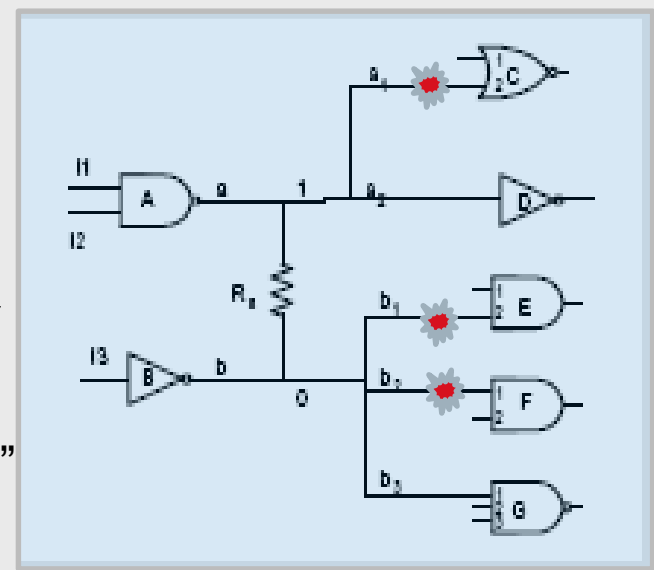
Rike on **ebamäärane** ja deterministlikult mitte enam kirjeldatav

Konstantne rike

Tingimuslik rike
konstantriike loogika-
kitsendusega
Üks rikkesignaal

X-rikke mudel
Byzantine'i rike
Lühised
"Rippuvad ühendused"
Palju rikkesignaale

Takistuslik lühis



Riistvara Troojad

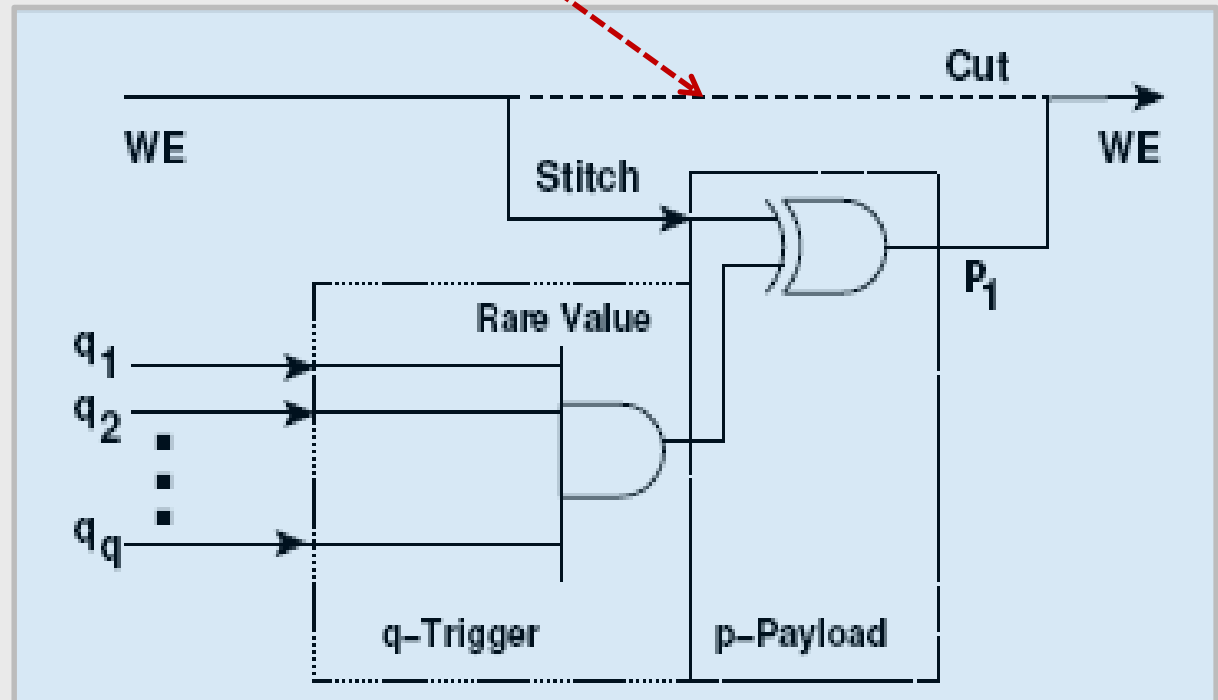
“Trooja hobune”

istutatakse skeemi integraalskeemide tootmisprotsessis, kusjuures ta aktiveerub väga harva esineva oleku või mingi ajalise sündmuse puhul.

Trooja aktiveerumise

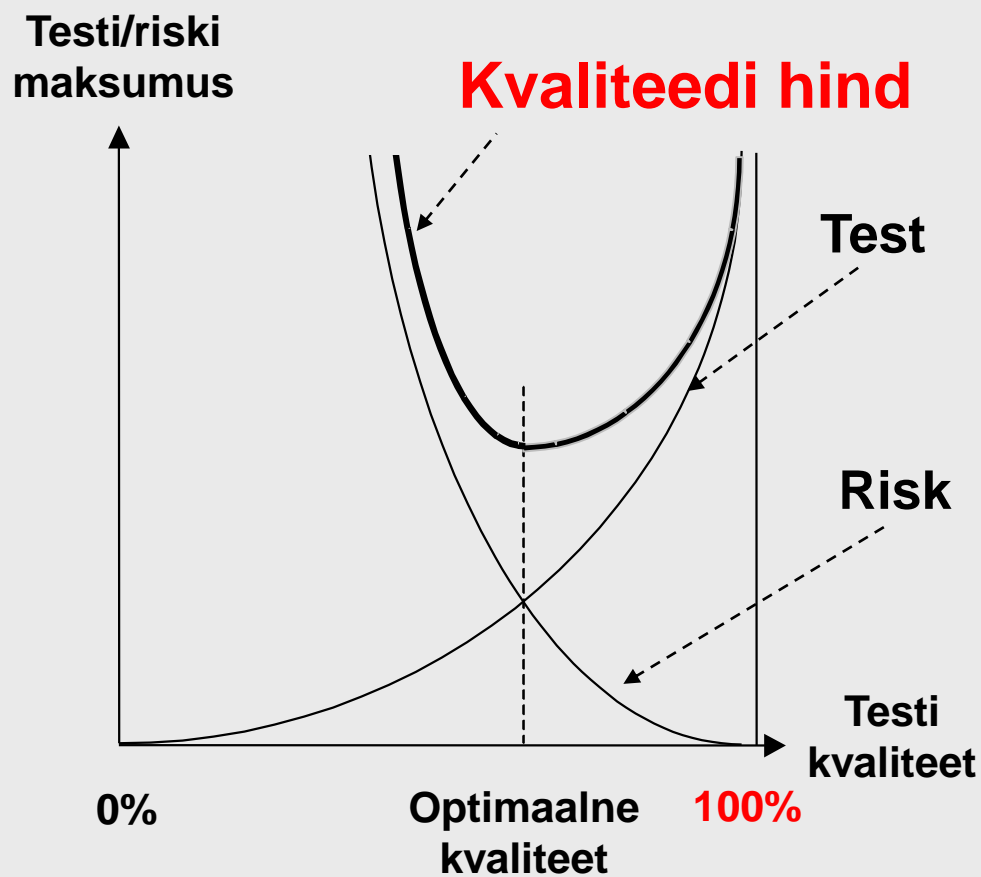
korral võidakse moonutada või hävitada andmeid, edastada näiteks radio teel salajast infot või hävitada kogu kiip.

Siit peab minema õige signaal



© F.Wolf, Ch. Papachristou, S.Bhunia, R.S.Chakraborty 2008

Kui palju on vaja testida?



How to succeed?

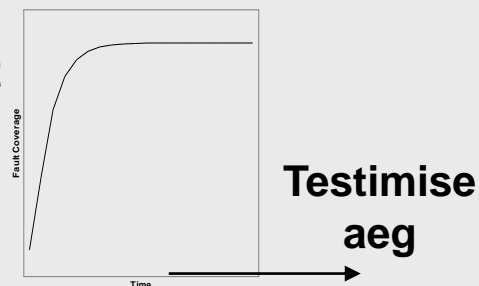
Try too hard!

How to fail?

Try too hard!

(From American Wisdom)

Testi kvaliteet



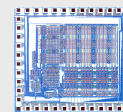
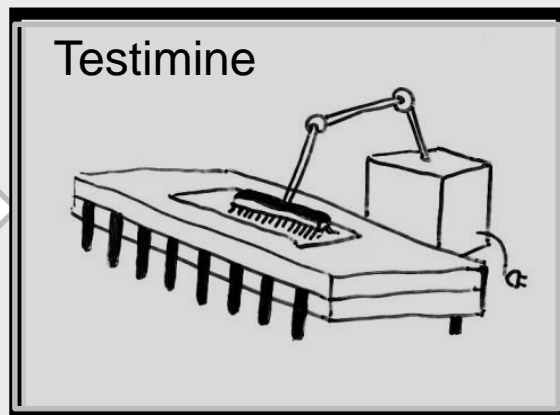
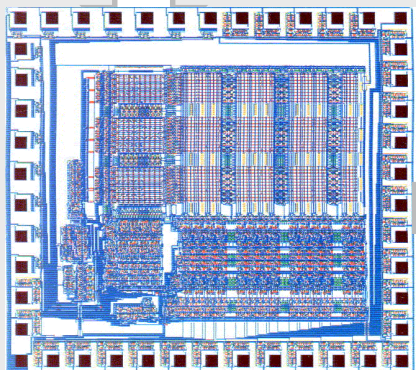
“The problem of testing can only be contained not solved”

T. Williams

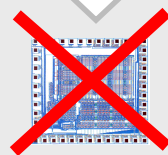
Kvaliteedi poliitika

Kiibid
tootmisest

Saagis $Y = (1 - P)^n$ Näiteks 60%, ülejäänud on on vigased kiibid



n - Rikete hulk
 P - Rikke tõenäosus



m - Testitud rikete hulk

T - Testi kvaliteet (rikete kate)

P_a - Vigase toote aktsepteerimise tõenäosus

Plaadile mineva kiibi kvaliteet - DL (defekti tase)
Mitu vigast protsessorit sajabst "poeb" läbi?

$$DL = \frac{P_a}{(1 - P)^n + P_a} = 1 - (1 - P)^{n-m} = 1 - Y^{\frac{n-m}{n}} = 1 - Y^{(1-\frac{m}{n})} = 1 - Y^{(1-T)}$$

$$P_a = (1 - P)^m - (1 - P)^n$$

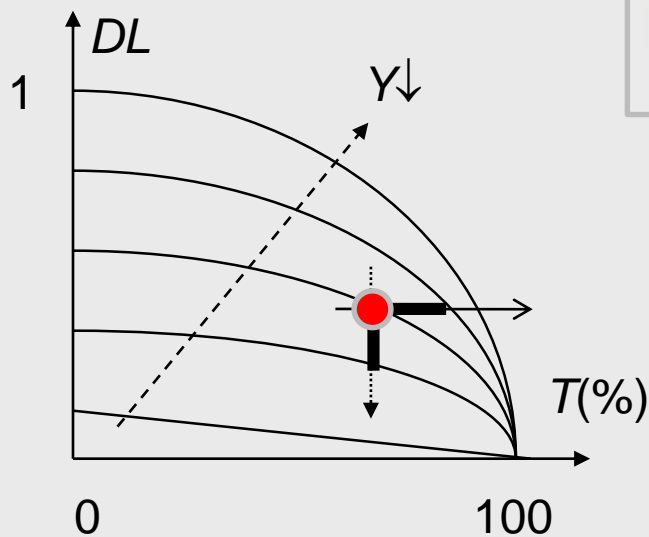
Kvaliteedi poliitika

Testi kvaliteet

Saagis

Defektide tase:

$$DL = 1 - Y^{(1-T)}$$



Testimata
kiibi
kvaliteet
(saagis)

Testitud kiibi
kvaliteet

DL

$Y(\%)$			
90	8	5	1
50	45	25	5
10	81	45	9
	10	50	90
	$T(\%)$		

Testide
kvaliteet

Struktuurse testimise probleemid

Keeruka süsteemi testimine:

Testimise signaalid

Testitav komponent

Tulemuse jälgimine



Aktiveeritud plokid

Täiendavalt aktiveerunud plokid võivad moonutada tulemust

Näide:

32-bitine summaator

Funktsionaalne test:

$2^{64} = 10^{19}$ testvektorit

Struktuurne test:

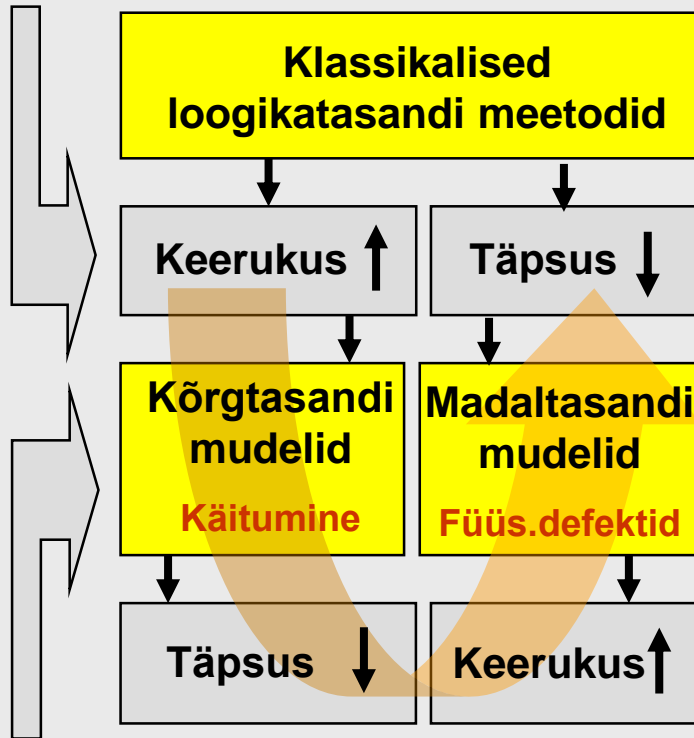
Kokku ca 2000 riket

Testvektorite arv

$N \ll 2000 \ll 10^{19}$

Keerukus vs. täpsus

Probleemid



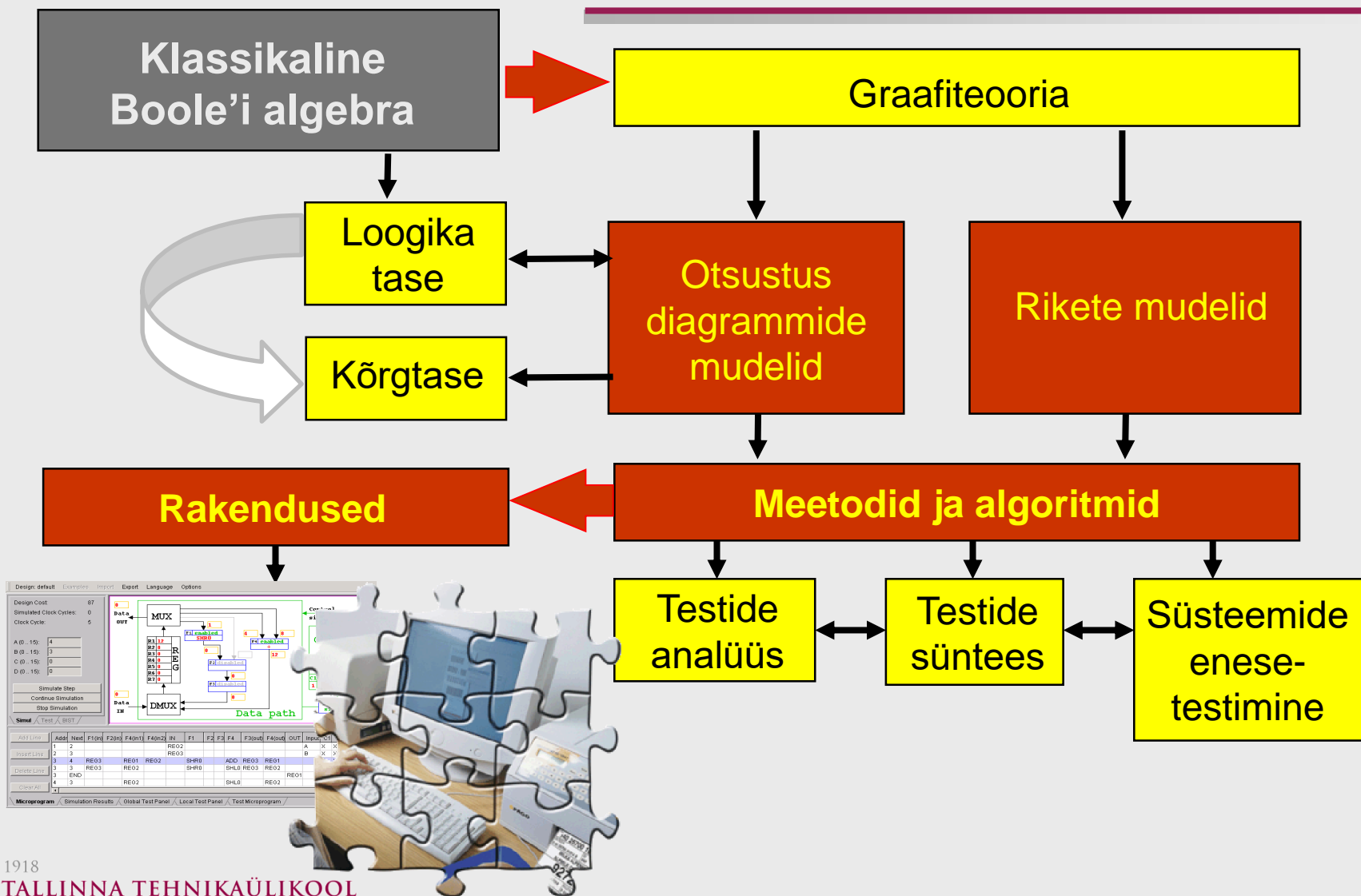
Võimalikud lahendused

Traditsioonilised **funktsionaalsed mudelid** kaotavad oma jõu süsteemide **keerukuse** kasvu tõttu

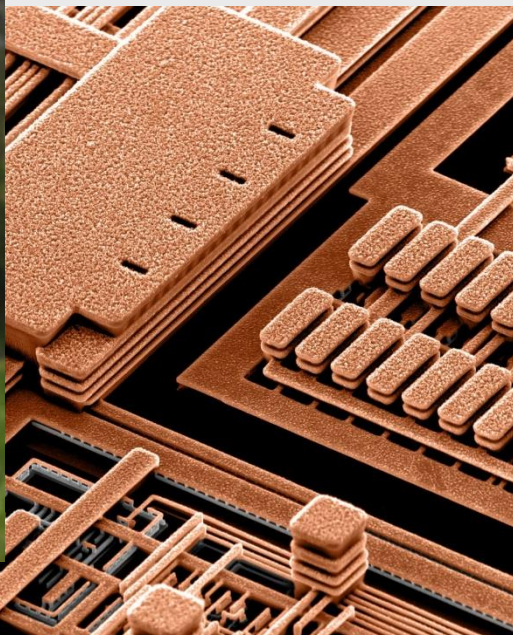
Traditsioonilised **rikete mudelid** ei suuda garanteerida piisavat testimise **täpsust** üha uuenevate nanotehnoloogiate ilmumisel

Väljapääs:
Hierarhilised lähenemisviisid
Uued rikke mudelid

Uurimistööst Tehnikaülikoolis



Modelleerimise hierarhiast



Soovitava süsteemi
spetsifikatsioon



Algoritm

Programm

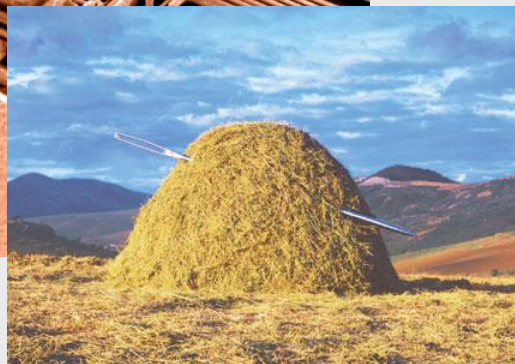
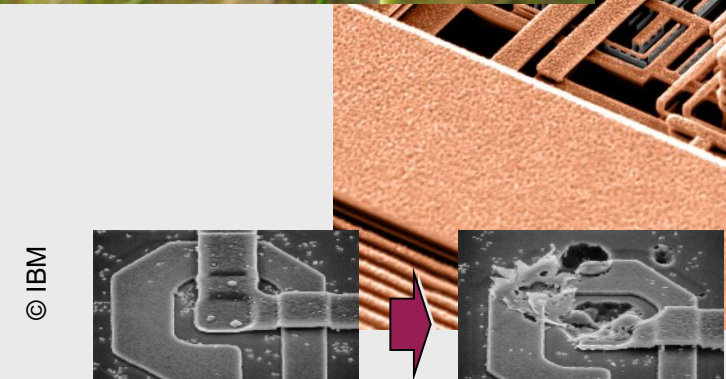
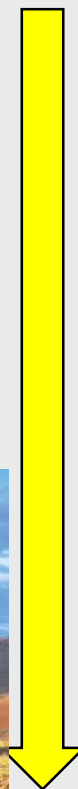
Arhitektuur

Struktuur

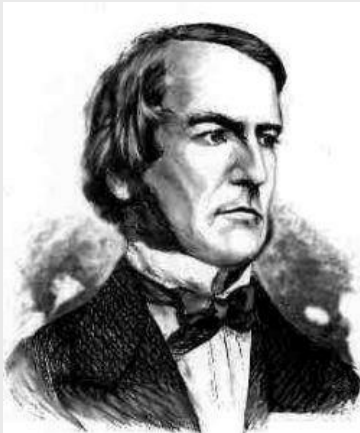
Loogika

Elektronika

Nano



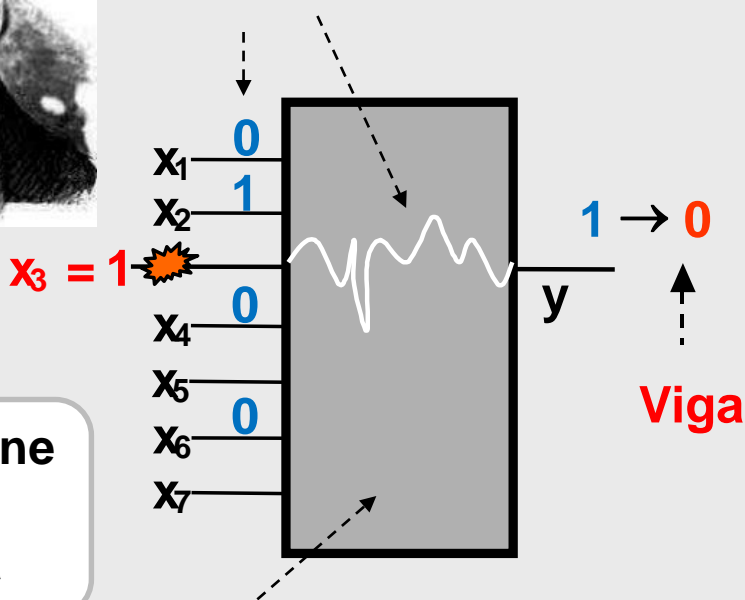
George Boole (1815 - 1864)



hubpages.com

Graafid ja loogikaskeemid

Signaali tee aktiveerimine läbi skeemi

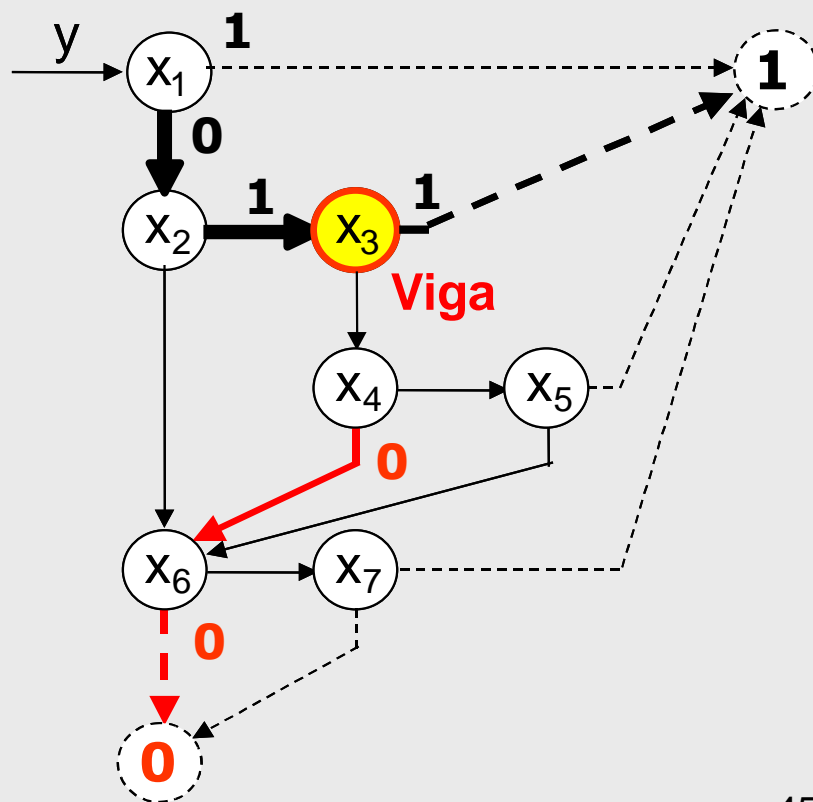


Klassikaline Boole'i algebra

$$y = x_1 \vee x_2 (x_3 \vee x_4 x_5) \vee x_6 x_7$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial x_3} (x_1 \vee x_2 x_3 \vee x_2 x_4 x_5 \vee x_6 x_7) = x_2 = 1$$

Sama probleemi lahendamine graafiteooria abil: otsustusdiagrammid



Otsustusdiagrammide (BDD) ajalugu

- 1959 – **Lee C.Y.** – Binaarsed programmid
- 1974 – Diplomitöö, TTÜ (**Vaher/Ubar**) – Boole'i funktsioonide arvutamiseks
- 1976 – **Ubar R.** – **Alternatiivsed graafid** (esmakordselt diagnostika valdkonda)
- 1978 – **Akers S.B.** – **Binaarsed otsustusdiagrammid – BDD**
- 1881 – **Esimene** BDD-põhine testide generaator (**KÜBI/TTÜ koostöö**)
- 1983 – **Ubar R.** – BDD üldistamine **esmakordselt** kõrgtasandile mikroprotsessorite testprogrammide sünteesiks (tippkonverents Milaanos)

- 1986 – **Bryant R.E.** – BDD kanoonilise mudelina – **algas BDD ajastu**
- 1990 – Esimene BDD programmide pakett (Bryant)

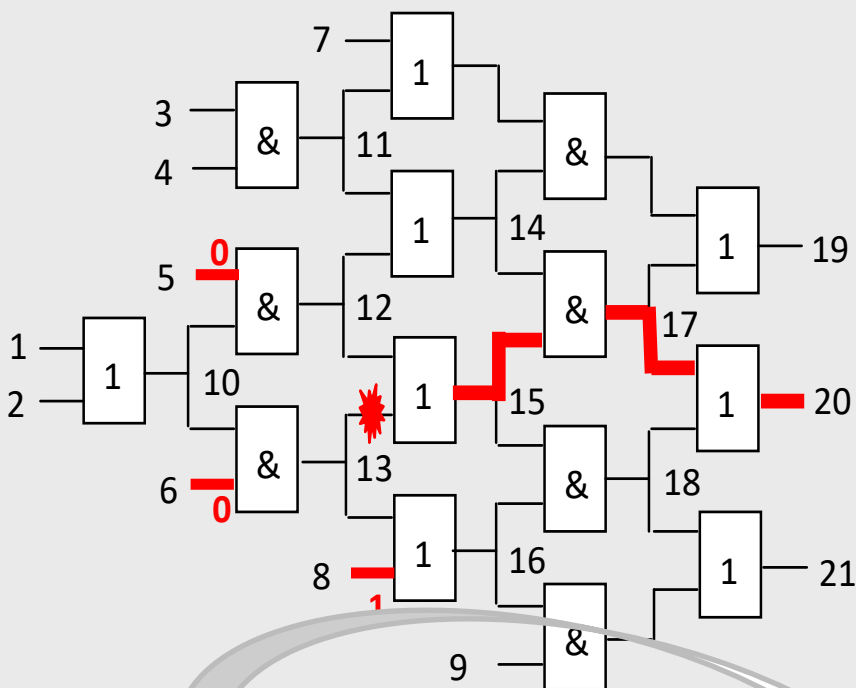
TTÜ panus arvutiteadusse:

Struktuurne BDD – erinevalt klassikalisest BDD-st võimaldab see mudel esitada digitaalskeemi struktuurseid omadusi

Kõrgtaseme DD – võimaldab südteemide diagnostilist modelleerimist kõrgel käitumuslikul tasandil

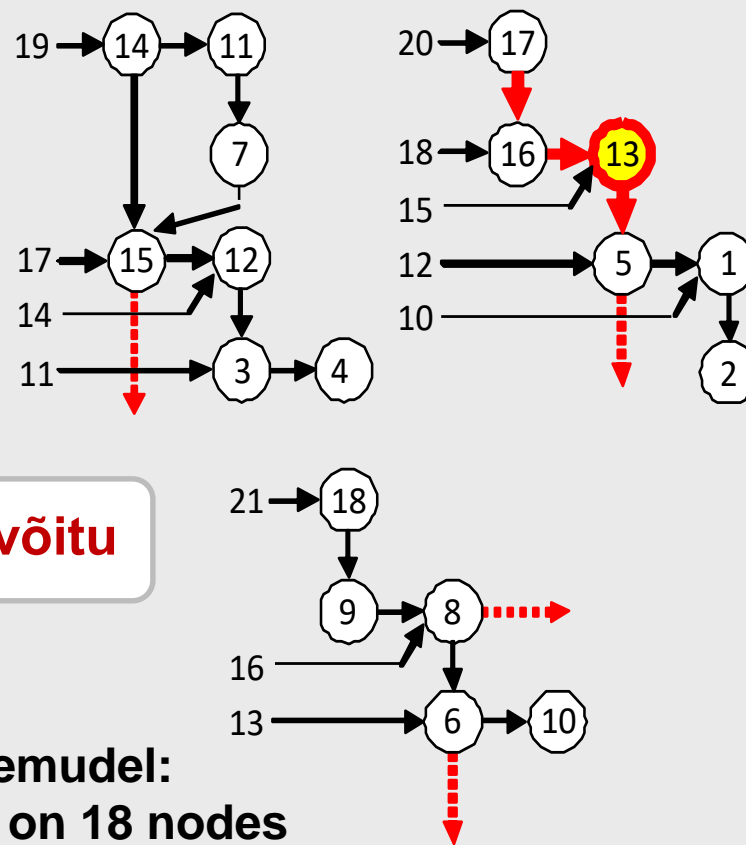
Uut tüüpi graafid

Klassikaline mudel: Loogikaskeem



Klassikaline rikkemudel:
84 riket 42 ühendusel

Uus TTÜ mudel: Struktuursed otsustusdiagrammid

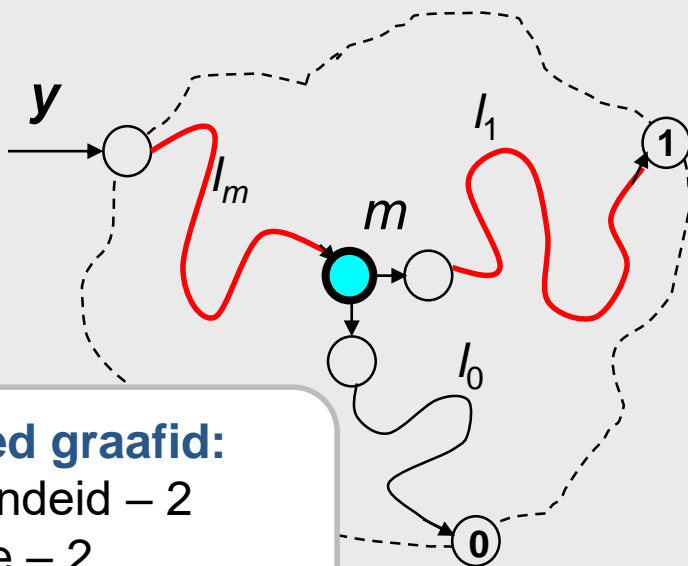


2,3 x võitu

Uus rikkemudel:
36 faults on 18 nodes

Graafide üldistamine

Loogikaskeemi graaf

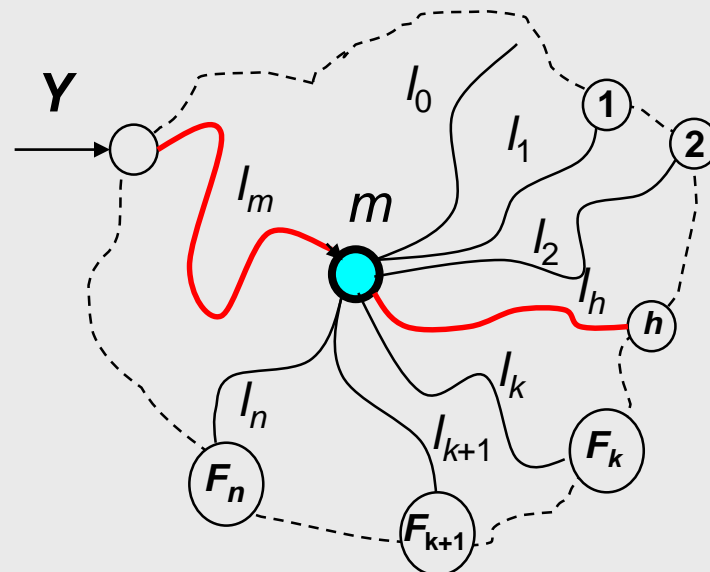


Binaarsed graafid:

Tipuväljundeid – 2
 Terminale – 2
 Terminalides konstandid

Uendus: Boole'i meetodite laiendus graafiteooria abil kõrgematele funktsionaalsetele tasanditele

Diagnostiline modelleerimine digitaalsüsteemidel

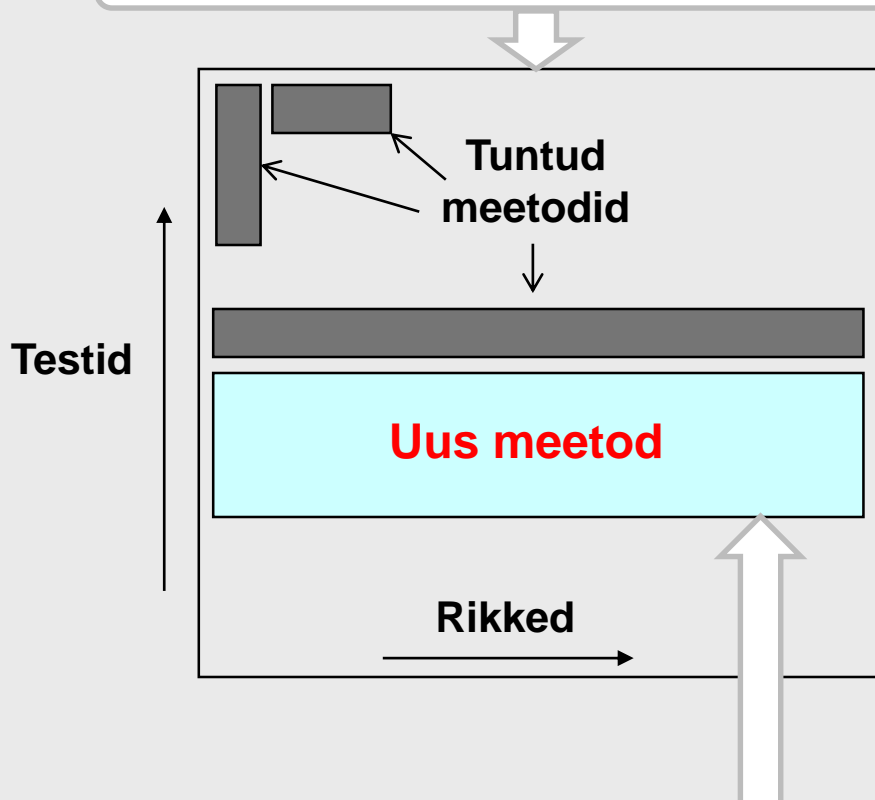


Kõrgtasandi graafid:

Tipuväljundeid ≥ 2
 Terminale ≥ 2
 Terminalides funktsioonid

Uut tüüpi rikete simuleerimise meetod

Eesmärk: Genereerida rikete tabel



Kasutatakse TTÜ struktuurigraafe

TTÜ meetod võimaldab suurendada simuleerimiskiirust võrreldes professionaalsete süsteemidega **Mentor Graphics** ja **Synopsys** keskmiselt **3-9 korda**

Uudne sünergia:

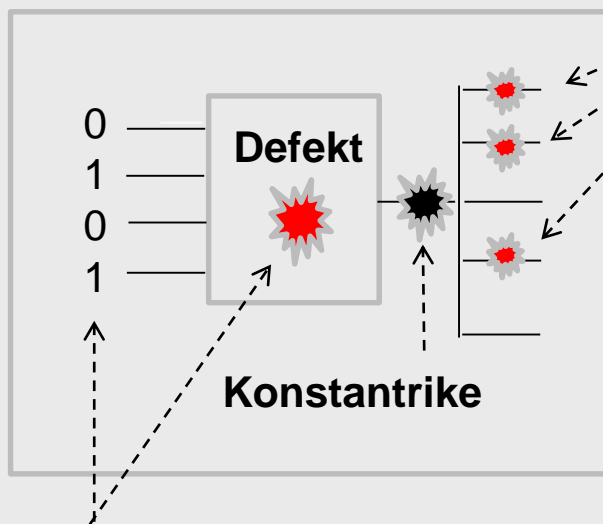
- (1) Analüütilisus
- (2) Paralleelsus

Praktiline tähtsus suur – palju kasutusvõimalusi:

disain, verifitseerimine
testide süntees
testide kvaliteedi analüüs
rikete diagnoos
süsteemide usaldatavuss

Uued defektide analüüsi meetodid

Määramatu (Byzantine'i) rike, X-rikke mudel

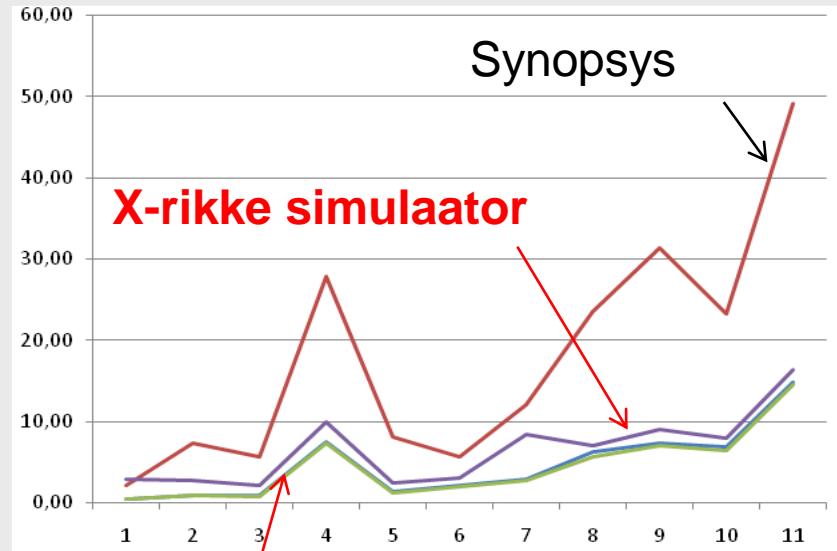


Tingimuslik konstant

DOT – Hierarhiline testide generaator

Võimaldas esmakordselt
tõestada defektide liiasust (mitteolulisust)

Simuleerimise aeg



Eri katseskeemid

**Konstantrikke simulaator,
DOT – defektide simulaator**

Kiipsüsteemide enesetestimine

- Välised testrid on väga kallid
- Ja nad on alati aeglasemad kui testitav kiip

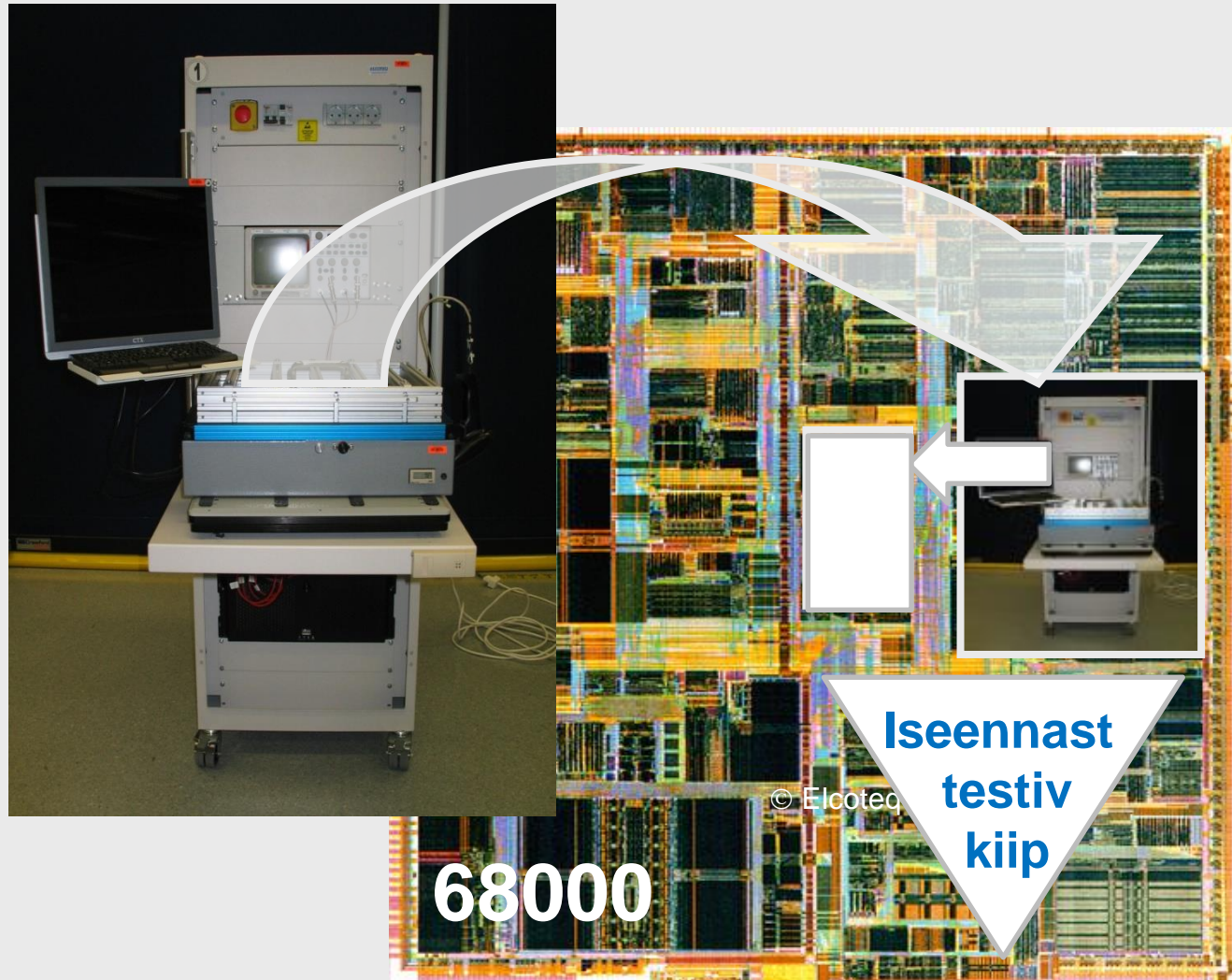


- **Kas poleks võimalik panna kiipe ise ennast testima**



68000

scienceblogs.com



68000

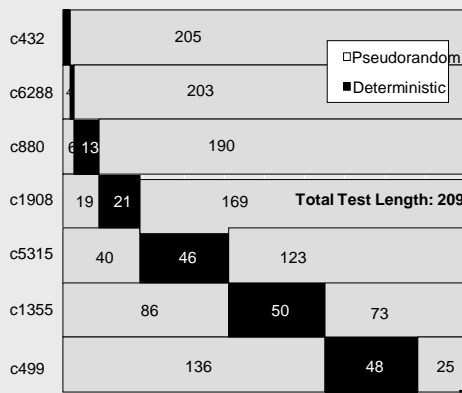
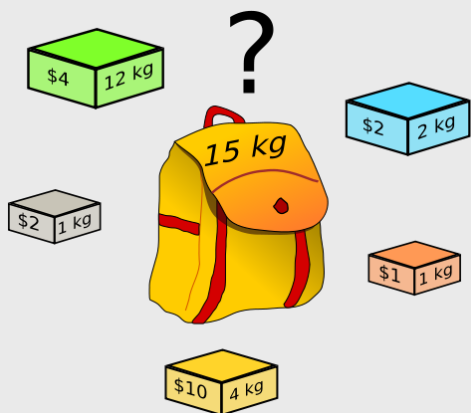
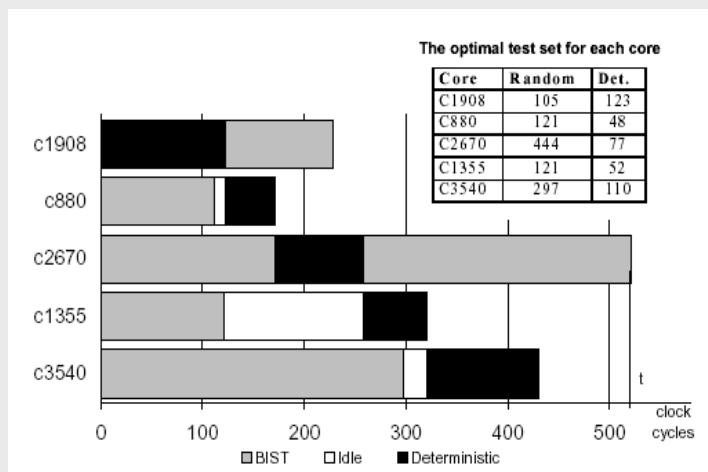
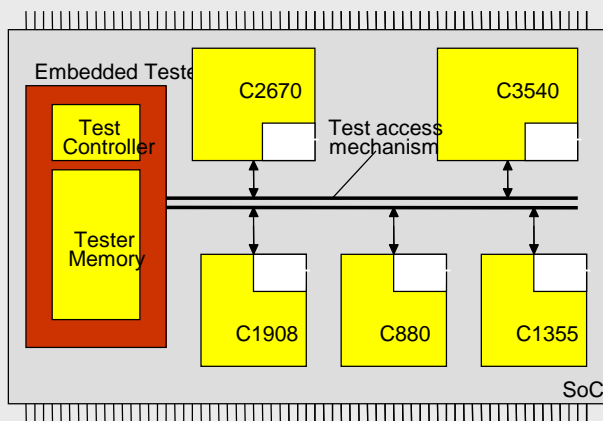
Iseennast
testiv
kiip

© Elcoted



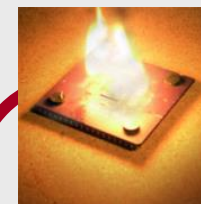
Enesetesti optimeerimine

Kuidas minimeerida testprotsessi kestvust
piiratud mälumahu puhul?



Aeg ↓

Temperatuur



Testimise režiim

Normaalne töörežiim

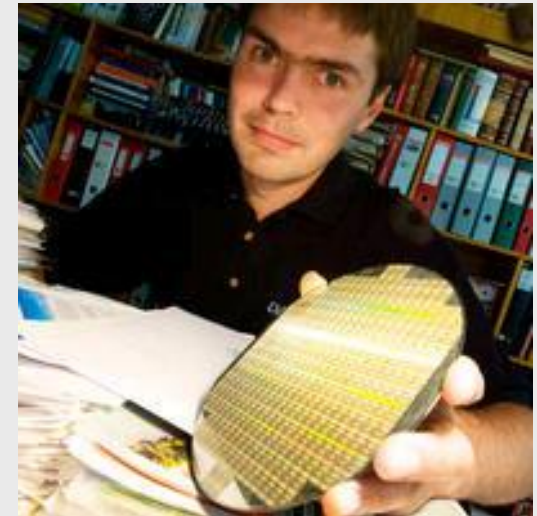
Aeg

ATI tulemusi

Tarkvara tööriistu:

- **DOT** – defektide tasandi testide süntesaator ja analüsaator
- **TURBO-TESTER** – loogikatasandi testide süntesaator ja analüsaator
- **Rikete simulaator** – eri tüüpi rikete klassidele loogikatasandil
- **DECIDER** – kõrgtasandi testigeneraator
- **APRICOT** – disainide verifitseerimine
- Kõrgtasandi **disainivigade lokaliseerija**
- FPGA-põhine **testiakseleraator**

ATI koordineerib FP7 europrojekti **DIAMOND**



ATI koordineerib REGPOT europrojekti **CREDES**

U Verona, TU Darmstadt, TU Brandenburg, U York, U Aveiro, Göpel Electronic

Partnerid: IBM, Ericsson...

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Linköpings universitet

Universität Bremen

TU Graz

ERICSSON

IBM

TRANSEDA VERIFICATION FROM CONCEPT TO REALITY

TESTONCA www.testonica.com

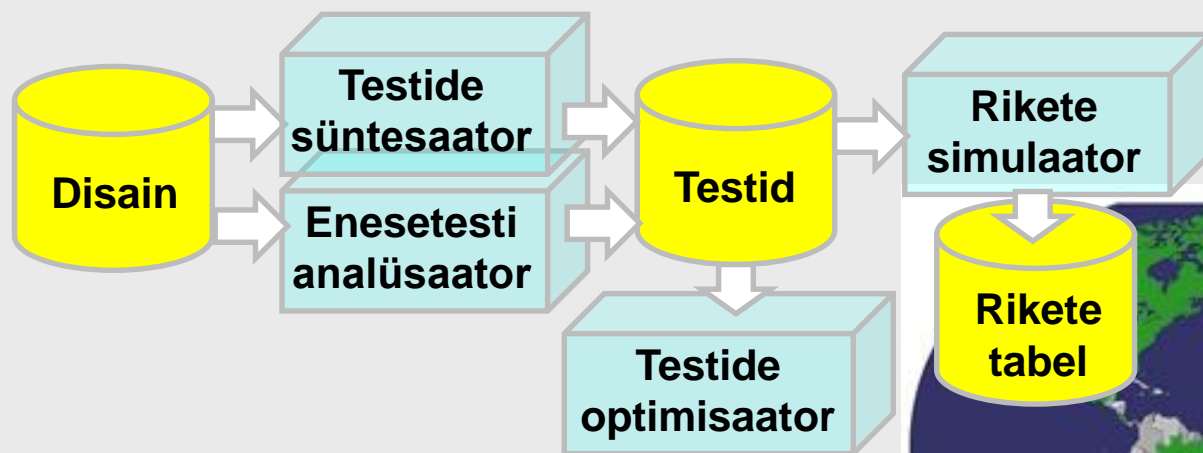
DIAMOND | Diagnosis, Error Modelling and Correction
EU's 7th FP IST Collaborative Project | for Reliable Systems Design

ATI rakendusi



Indoneesia

Loogikataseme diagnostika süsteem TURBO-TESTER



Tarkvarakeskkond

Liidesed peamistele professionaalsetele CAD-süsteemidele

Litsenseeritud 110+ instituudis 45+ riigis



ATI e-õppe tarkvara

Java appletid klassiruumi, koju, laborisse ja eksamiks:

Loogika tasandi
diagnostika

Introduction to Testing and Diagnostics [Design 5 : Insert Testvectors]

Designs Work steps Language Help

LFSR Working mode

BILBO

CSTP

Setup

11 S

12 S

13 S

14 S

15 S

16 S

15

Run LFSR

Step

Clear

Manual LFSR

Circuit

Fault table

#	X2	X3	X1	10=q	X4	X5	11=q	13=b	X6	13=q	14=q	15=q	X7	16=q	Diff	Sum
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0.0	66.7
10	1	1	X	1	X	1	1	X	X	1	X	1	1	1	20.0	86.7
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0.0	86.7
12	X	X	1	X	X	X	1	X	X	1	X	1	1	1	3.3	90.0
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0.0	90.0

Test vectors Fault table Waveforms General information

Java Applet Window

Süsteemi tasandi
diagnostika

Design: default Examples Import Export Language Options

Design Cost: 87

Simulated Clock Cycles: 0

Clock Cycle: 5

A (0..15): 4

B (0..15): 3

C (0..15): 0

D (0..15): 0

Simulate Step

Continue Simulation

Stop Simulation

Simul Test BIST

MUX

DMUX

REG

Control signals

Data path

Status signals

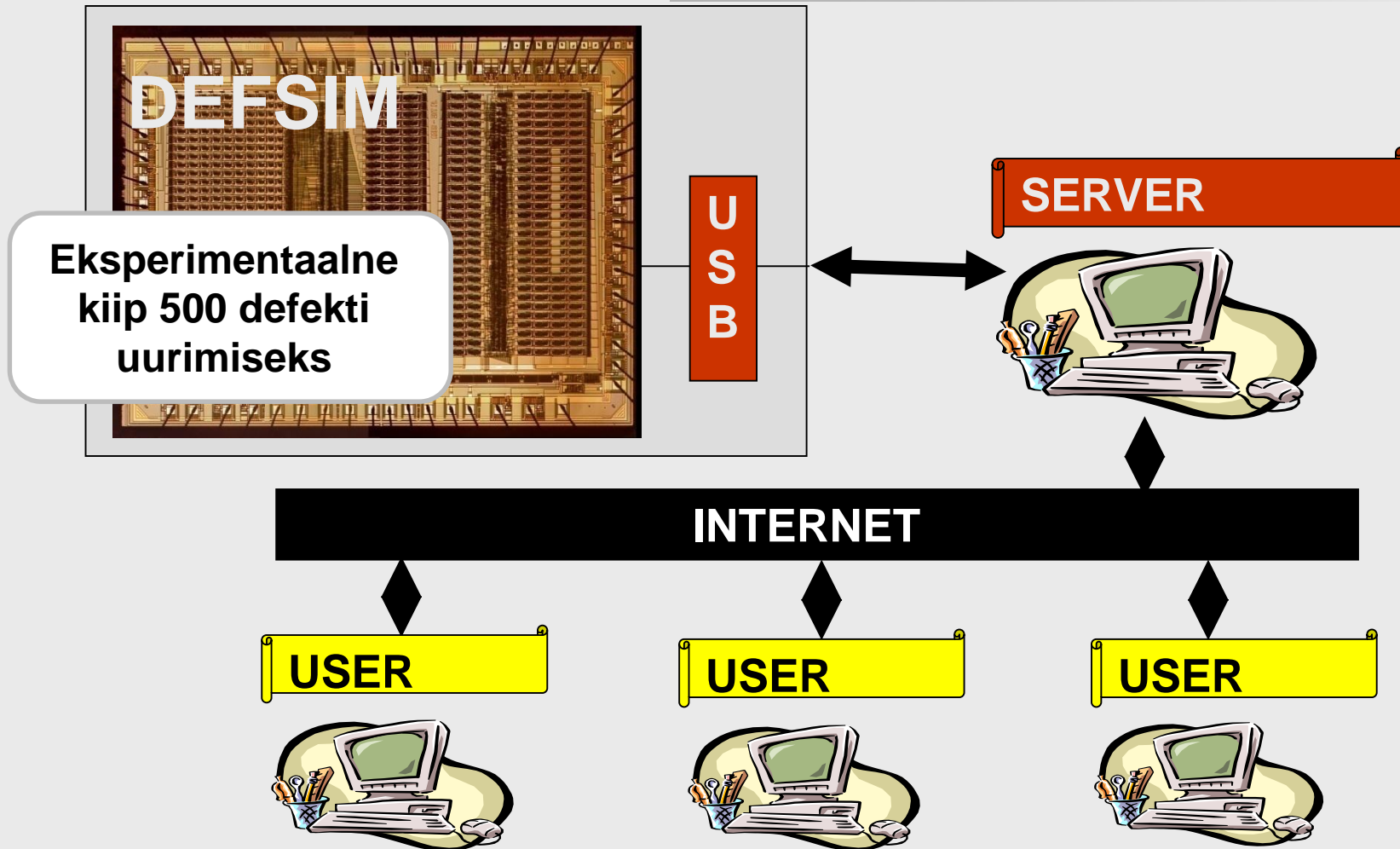
C1C2C3C4C5C6C7C8
10000010

Add Line	Addr	Next	F1(m)	F2(m)	F4(m1)	F4(m2)	IN	F1	F2	F3	F4	F3(out)	F4(out)	OUT	Input	C1	C2	C3	C4
1	2						REG2								A	X	X	X	X
2	3						REG3								B	X	X	X	X
3	4	REG3	REG1	REG2			SHR0	ADD	REG3	REG1					X	X	0	X	
3	3	REG3	REG2				SHR0	SHL0	REG3	REG2					X	X	1	X	
3	END														X	X	X	X	
4	3		REG2							SHL0		REG2			X	X	X	X	

Microprogram Simulation Results Global Test Panel Local Test Panel Test Microprogram

<http://www.pld.ttu.ee/applets/>

ATI virtuaalne laboratoorium



Uurimiskeskond TTÜ ATIs

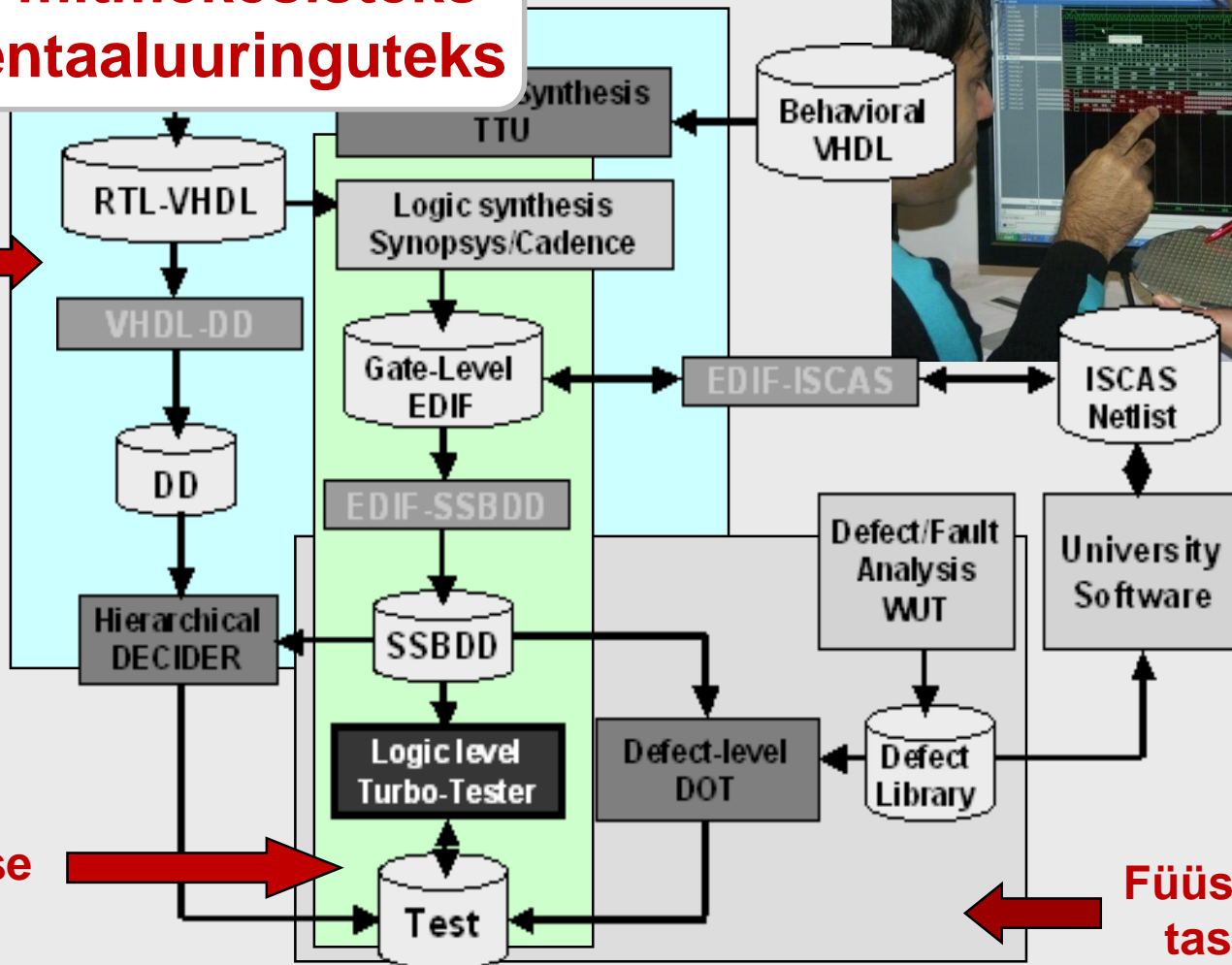
Võimalus mitmekesisteks eksperimentaaluuringuteks

Kõrge käitumuslik tase

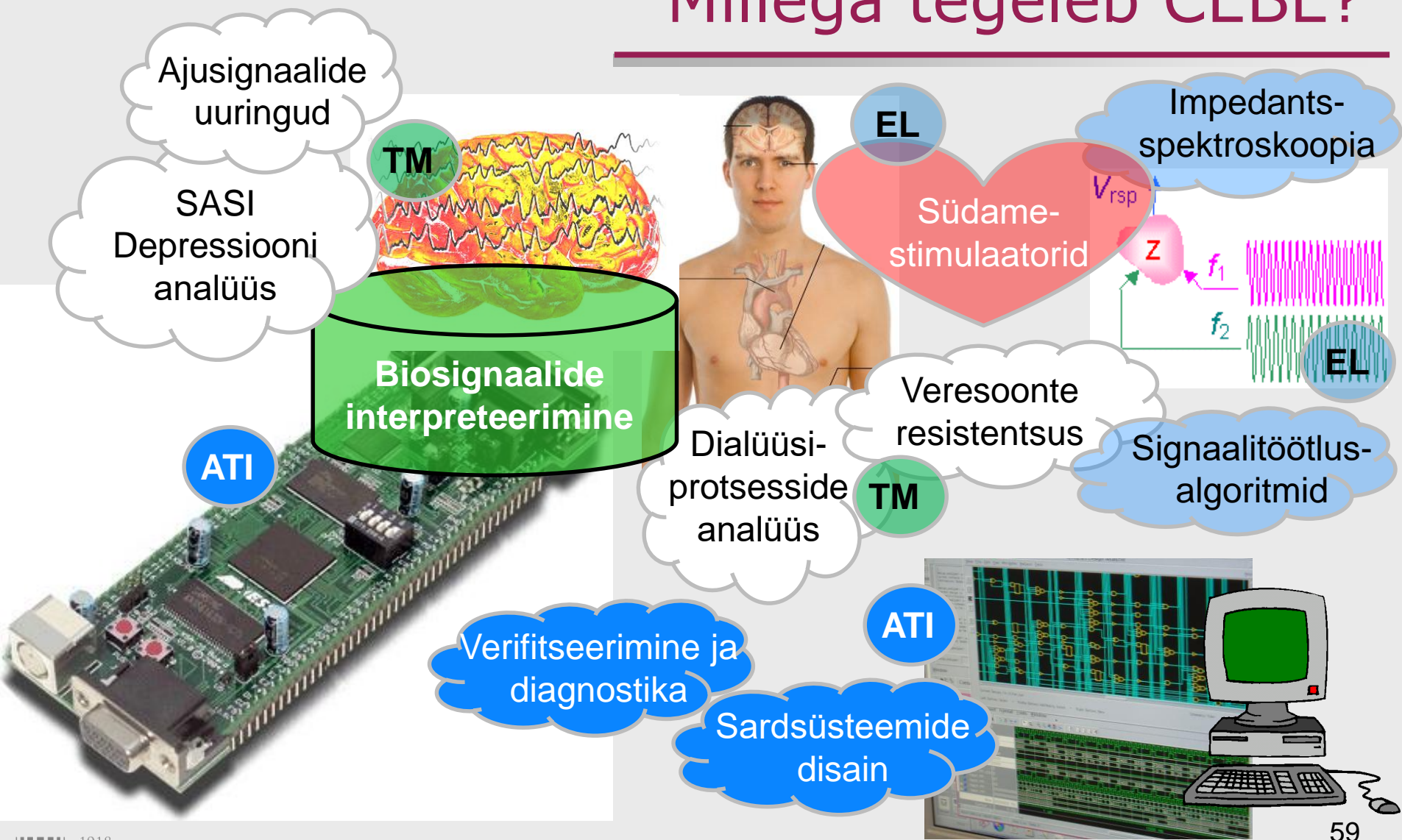
Jaga ja valitse

Loogikatase

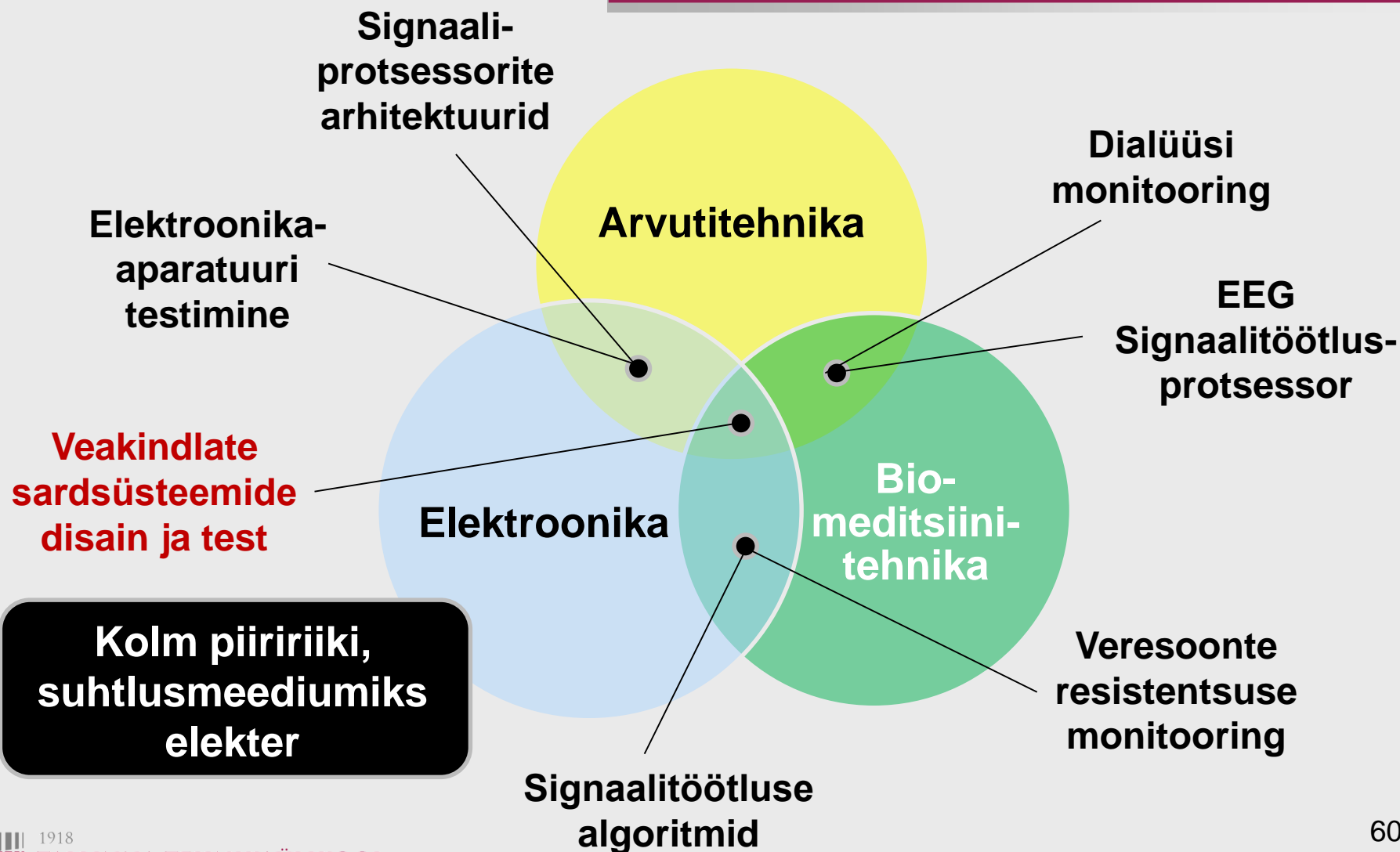
Füüsika tase



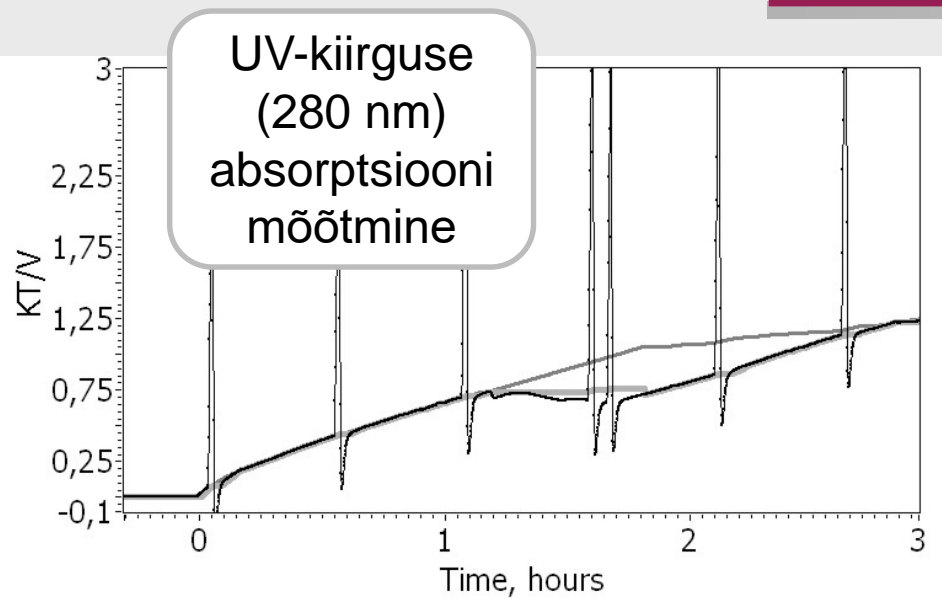
Millega tegeleb CEBE?



Koostöö sünergiast CEBEs

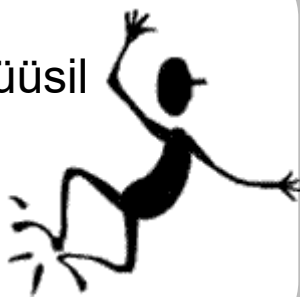


Koostöö: Tehisneeru töö monitooring



Sünergia:

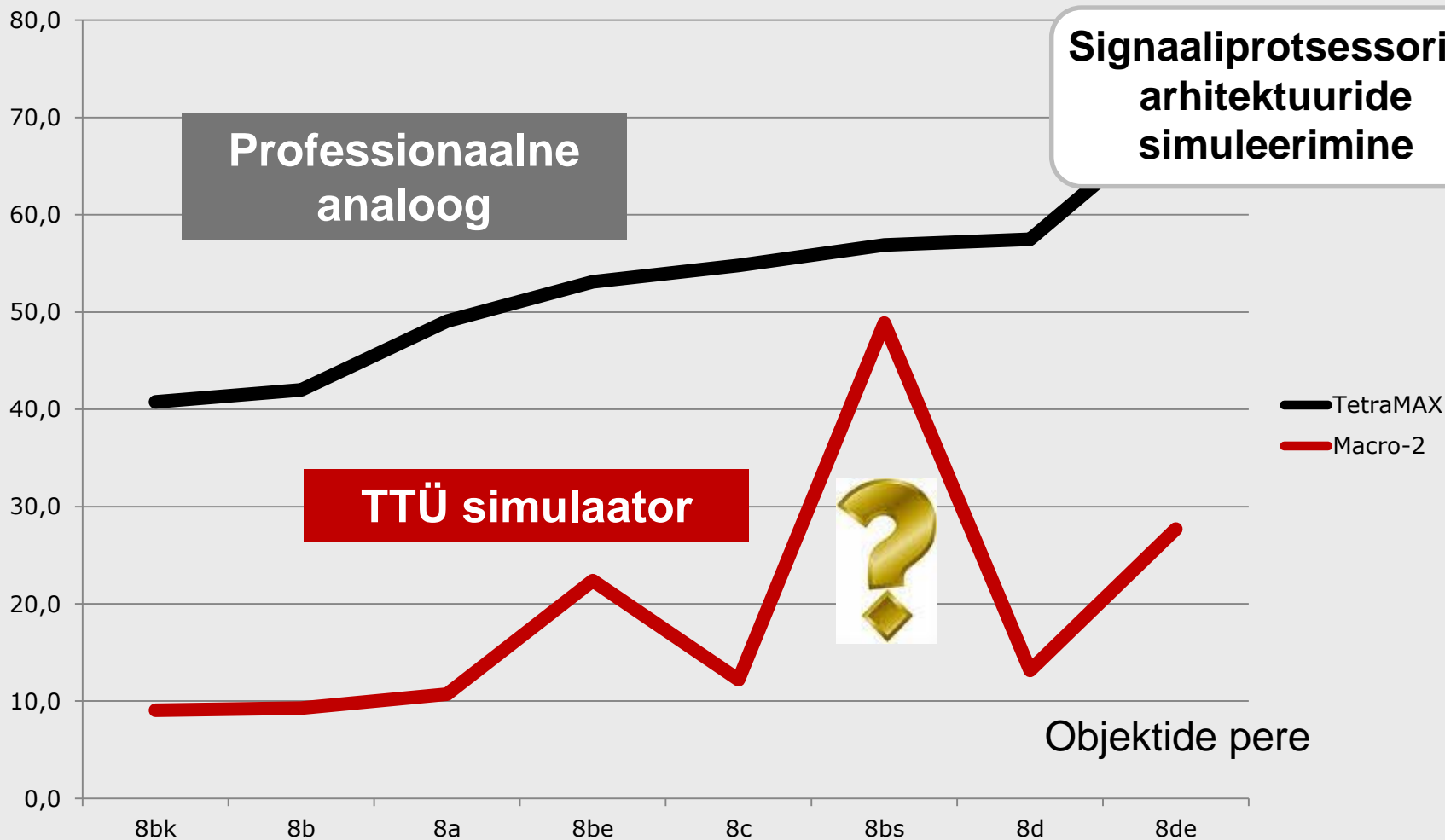
Bioprotsessi analüüsil
on rakendatud
elektroonika
diagnostika
algoritme



**Patsient hemodialüüsil SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla Dialüüsi- ja nefroloogia
osakonnas**

CEBE sünergiast

Simuleerimise aeg



Signaaliprotsessorite arhitektuuride simuleerimine

Professionaalne analoog

TTÜ simulaator

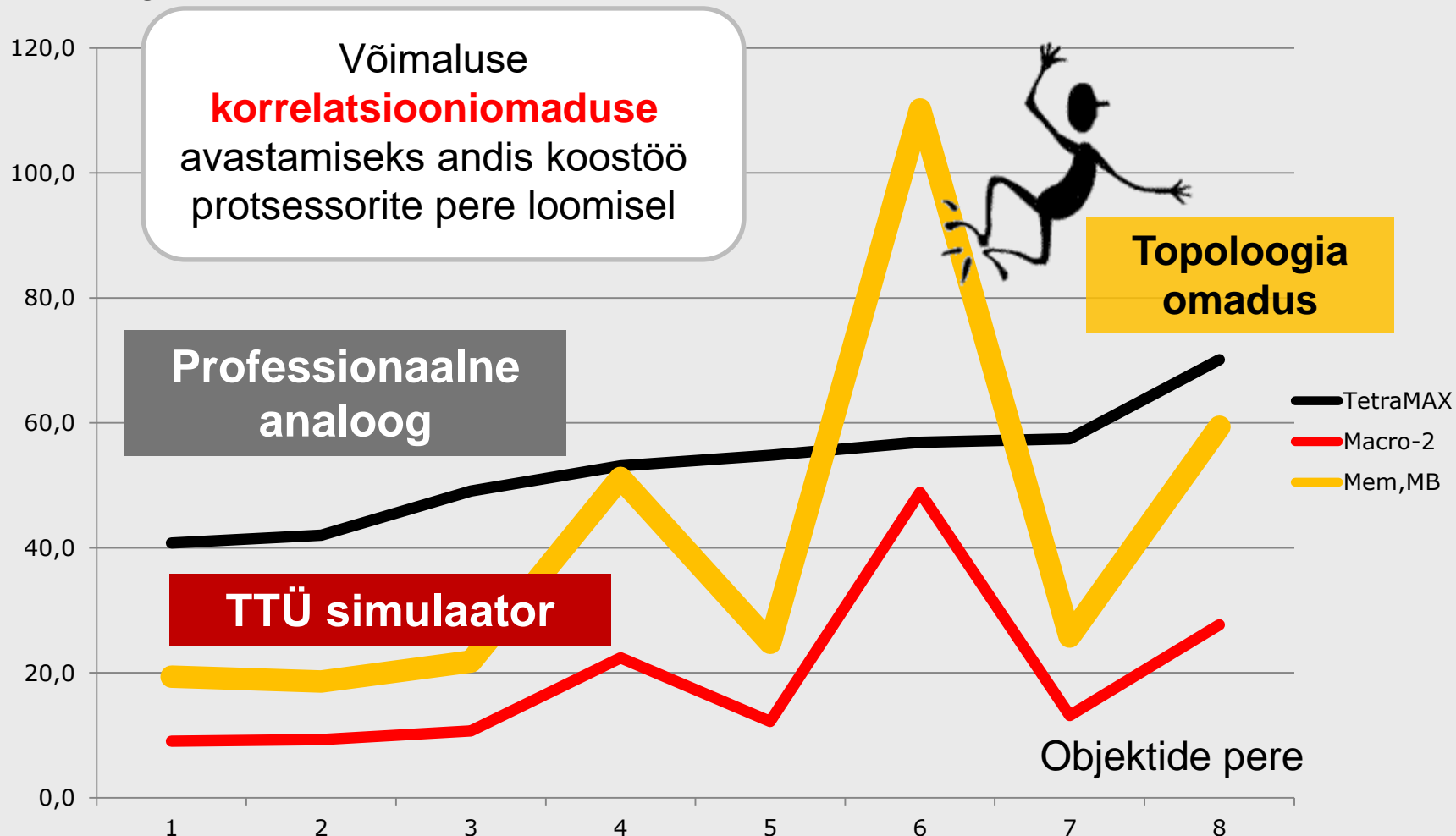


Objektide pere

— TetraMAX
— Macro-2

CEBE sünergiast

Simuleerimise aeg



Quo vadis, teadus?

- ✓ Maailm ja selle olemus on muutumas. Kõik uus, mis tekib, tekib eeskätt tänu arvutite võimsusele
- ✓ **Seaduspärasuste** (põhjus-tagajärg seoste) avastamine asendub *korrelatsioonide* avastamisega infomassiivides
- ✓ Kolme fundamentaalse avastusega – **aatom, geen ja arvuti** on põhilised mateeria, elu ja arvutamise seadused ära tunnetatud
- ✓ *Romantiline* teaduslike avastuste periood (**Age of Discovery**) asendub *pragmaatilise* teaduse rakendamise perioodiga (**Age of Mastery**)
- ✓ *Innovatsiooniliidriteks* saavad mitte tehniliste uuenduste loojad, vaid need, kes tegelevad rakenduse kontekstiga

Tehisintelligents?

- ✓ **Tehisintelligents** – valdkond, kus ülesandeks on programmeerida arvuteid tegema seda, mida seni on suutnud vaid inimene
- ✓ Kui arvuti on ülesande lahendanud, siis sellest hetkest peale see ülesanne ei kuulu enam tehisintelligentsi valdkonda
- ✓ **Järelikult ei saa tehnoloogia inimest mitte kunagi kätte**

- ✓ Mis vahe on **arvutiteadusel** ja **tehisintelligentsil**?
Nendest ülesannetest, mida on suudetud lahendada, on saanud *arvutiteaduse* valdkond
- ✓ Need aga, mis on jäänud lahendamata – see on *tehisintelligentsi* valdkond

Quo vadis, eesti insener?

- ✓ **Sardsüsteemide loomine** oleks loomupärane teaduse ja tehnoloogia väljund – lõpmatu innovatiivsuse allikas
- ✓ Suur osa on missiooni/elu kriitilised süsteemid
- ✓ Avarad kommertspektiivid: *tarkade asjade internet*
- ✓ **Rekonfigureeritavad FPGA tehnoloogiad** – programmeeritav pole mitte ainult tarkvara vaid ka riistvara
- ✓ Kuna meil ei ole väga kallist mikroelektroonika tööstust Eestis, siis programmeerime (loe: valmistame) ise selle, mida tööstuselt sooviksime
- ✓ **Tarkvarale taandatud töö** nõuab üksnes ajuressursse, seega
- ✓ **IT-alane kõrgharidus** peaks olema Eesti tähtsaim prioriteet, kuna mõjutab ükskõik milliseid muid teadusi või elualasid
- ✓ **Parim küberkaitse:** IT-alane riiklik sõltumatus